

STN の統計解析機能

概要

- STN では、回答の特定のフィールドと出現頻度を抽出することにより簡単に統計解析が行える。
- 統計解析の利用例
 - 企業動向調査
 - 特許ファイルで、特定の国・地域へ出願している企業を多い順に表示する。

例：医薬用、化粧品用製剤に関する中国特許の出願状況（WPINDEX ファイル使用）

	2003 年	2002 年	2001 年
1	AstraZeneca Ab	Yang M	Bode Gene Dev Co Ltd Shanghai
2	L'Oreal Sa	Bode Gene Dev Co Ltd Shanghai	Shanghai Biowindow Gene Dev Inc
3	Procter & Gamble Co	Shanghai Biowindow Gene Dev Inc	Procter & Gamble Co

- 特許ファイルで、特定企業の特許出願分野を特許件数の多い順に表示する。

例：キャノン（株）の出願分野の調査（WPINDEX ファイル使用）

	2003 年	2002 年	2001 年	
1	G03G	G03G	G03G	G03G: エレクトログラフィ、電子写真、 マグネトグラフィ H04N: 画像通信 G06F: 電氣的デジタルデータ B41J: タイプライタ、選択的プリンティング
2	H04N	H04N	H04N	
3	G06F	G06F	B41J	

- 技術動向調査

- 特許ファイルで、特定技術分野の特許出願人を特許件数の多い順に表示する。

例：携帯電話のディスプレイに関する特許出願人の調査（WPINDEX ファイル使用）

	2003 年	2002 年	2001 年
1	Seiko Epson Corp	Seiko Epson Corp	Semiconductor Energy Lab
2	Matsushita Denki Sangyo KK	Matsushita Denki Sangyo KK	Seiko Epson Corp
3	Semiconductor Energy Lab	Semiconductor Energy Lab	Matsushita Denki Sangyo KK

STN の統計解析機能

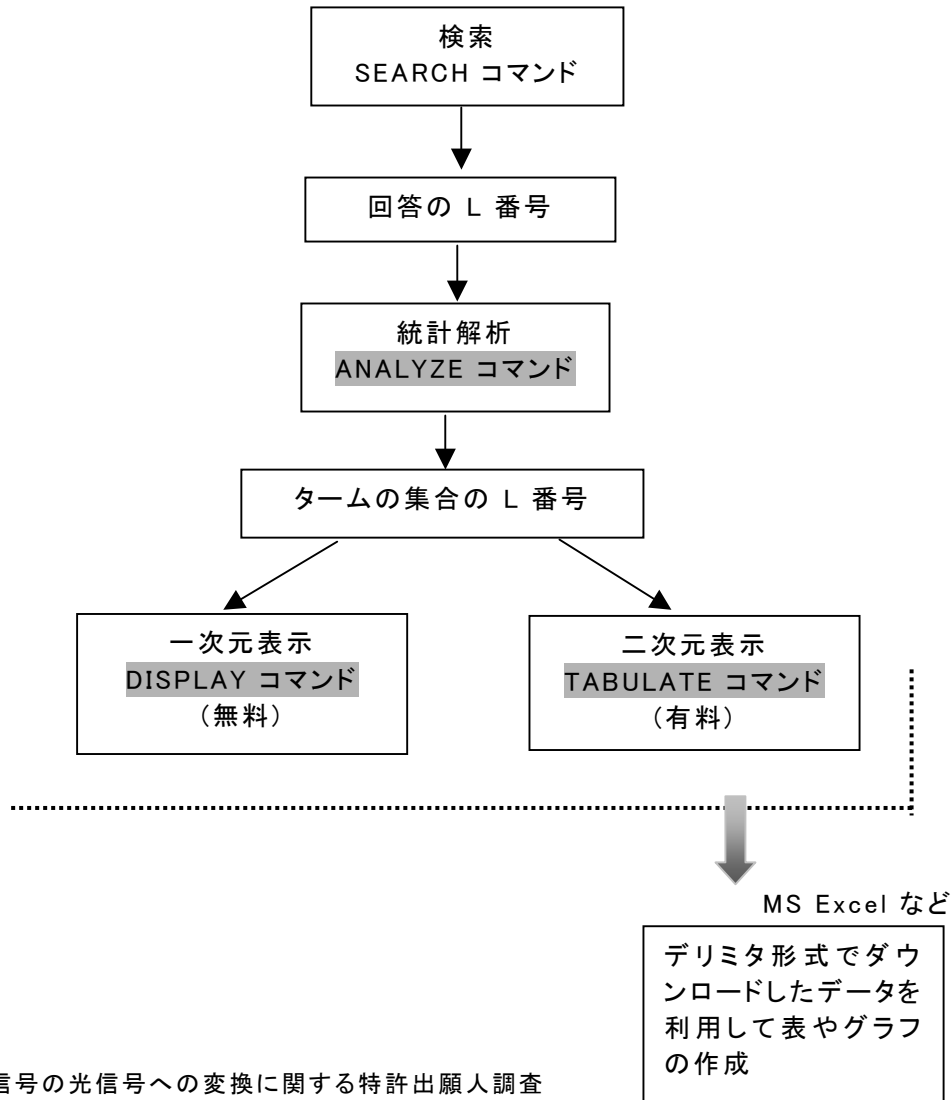
概要

- ・ 統計解析の利用例（続き）
 - ・ 特定の著者の文献の引用頻度の調査
 - ・ 質問式の改善
 - ・ 予備検索によって得られたレコードの索引語、分類コード、標題中のタームなどを確認し、本検索に使用する。
 - ・ 特定のテーマで検索した回答に索引されている IPC（国際特許分類）、NCL（米国特許分類）、コードなどを調べ、本検索に使用する。
- ・ STN の統計解析の特長
 - ・ 回答を出力せずに統計解析が実行できる（出力料が不要なので経済的）。
 - ・ ANALYZE コマンドで 5 フィールドまで同一料金でデータを解析（抽出）できる。
 - ・ ANALYZE した結果を無料で一次元表示（1 フィールドからの表示）することができる。（DISPLAY コマンド）
 - ・ ANALYZE した結果を二次元表示（2 フィールドを組み合わせた表示）することができる。（TABULATE コマンド）（有料）
 - ・ ANALYZE するファイルと表示するファイルは異なってもよい。従って、表示は接続時間料のかからないファイル（ZCA ファイルや ZCAplus ファイルなど）で行うと経済的である。
- ・ STN Express with *Discover!* V7.0 Analysis Edition の 2D Analysis ウィザードを使用すると、コマンドを知らなくとも統計解析を行うことができる（後述）。

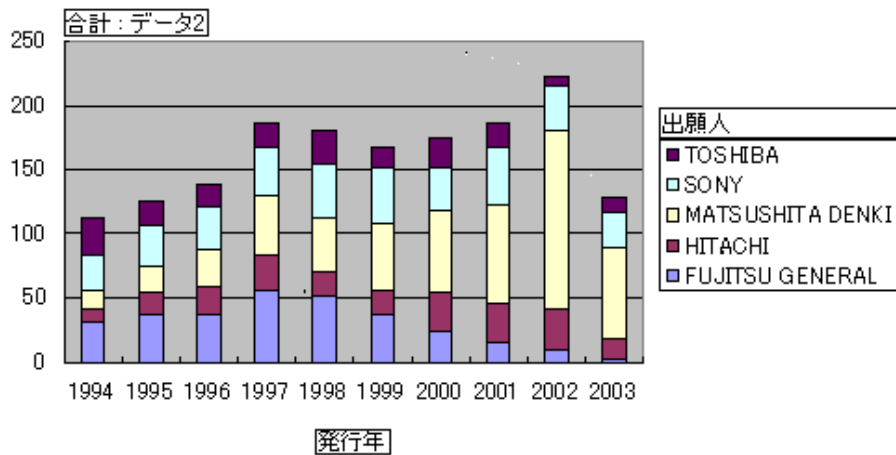
STNの統計解析機能

概要

・ 統計解析の流れ



電気信号の光信号への変換に関する特許出願人調査



STN の統計解析機能

ANALYZE コマンド

・ 入力方法

ANALYZE コマンドを利用する。ANA (3 文字) に省略できる。
省略しないと、初心者モードでの入力になる。(コマンド以外の入力は順不同)

=> ANA L 番号 回答番号 抽出フィールド 抽出オプション

・ デフォルト

- 回答セットの L 番号 : 直前の L 番号
- 抽出する回答番号 : 全件
- 抽出フィールド : ファイルにより異なる (サマリーシートの SELECT/ANALYZE フィールドを参照)
- 抽出用オプション : なし

・ 抽出フィールド

- 個々のフィールド (PA, PN, CT など) (サマリーシートの SELECT/ANALYZE フィールドを参照)
- 最大 5 フィールドまでスペース, またはコンマで区切って指定可能
- HIT コード名 (ヒットしたターム, HIT RN など)

・ 回答番号

- n-m (n, n,m または n- も可)

・ 抽出用オプション

- WITH "文字列" : 特定文字列 (20 文字まで指定可能) を含むタームの抽出
- NOT "文字列" : 特定文字列 (20 文字まで指定可能) を含まないタームの抽出
- LENGTH n : 文字数の限定 (先頭から n 文字 : n は文字数)

* WITH と NOT の併用は不可。1 フィールドを ANALYZE するときは、WITH/NOT と LEN の併用は可能。
複数フィールドを ANALYZE するときは、WITH/NOT と LEN の併用は不可。
LEN は複数フィールドの ANALYZE で利用できるが、各フィールドに対して LEN を指定する必要がある。
一つしか LEN を入力しないと最初のフィールドのみ適用される。

・ 入力例

=> ANA L1 1- PA ← L1 の全件から PA を ANALYZE する

=> ANA L1 PA PY.B ← L1 の全件 (デフォルト) から PA と PY.B を ANALYZE する

=> ANA L2 1-50 PN WITH "JP" ← L2 の 1 番目から 50 番目の回答から "JP" の文字列を含む PN を ANALYZE する

=> ANA L2 ICM.B LEN 4 PY.B ← L2 の全件から ICM.B の先頭 4 文字 (サブセクション) と PY.B を ANALYZE する

=> ANA L2 PAX LEN 6 ICM.B LEN 4 ← L2 の全件から PAX (特許出願人 + コード) の先頭 6 文字と ICM.B の先頭 4 文字を ANALYZE する

STN の統計解析機能

ANALYZE コマンド

- ANALYZE コマンドの制限値と料金

(2004 年 2 月現在)

制限値	50,000 回答まで (ただし, 最大 50,000 タームまで)
料金	料金は、回答セットの回答件数に依存する 1 ~ 1,000 件 1,400 円/回 1,001 ~ 10,000 件 2,400 円/回 10,001 ~ 50,000 件 3,210 円/回



5 フィールドまで同一料金で ANALYZE できるので、統計解析予定のフィールドをまとめて ANALYZE しておくとお得である。

- 一旦 ANALYZE コマンドで抽出したタームをさらに ANALYZE することができる。
(追加料金なし)

- 二次的 ANALYZE で指定できる抽出範囲

- 1- または ENTIRE : 全ターム
- ターム番号 (m-n) : 指定した範囲のターム
- TOP n : 上位 10 位までのターム
- OGT n : 出現頻度が n より多い (n は含まない) ターム
- DGT n : レコード数が n より多い (n は含まない) ターム
- PGT n または %GT n : レコード数の全体に占める割合が n % より多い (n は含まない) ターム

- 入力例

=> ANA L3 1- PN ← 回答全件から PN を ANALYZE する
L4 ANALYZE L3 1- PN : 953 TERMS

=> ANA L4 1- WITH "JP" ← さらに L4 の全タームのうち JP を含むタームを ANALYZE
L5 ANALYZE L4 1- WITH "JP" : 608 TERMS する (無料)

=> ANA L1 PA ← 回答全件から PA を ANALYZE する
L6 ANALYZE L1 1- PA : 3145 TERMS

=> ANA L6 TOP10 ← さらに L6 の上位 10 位をさらに ANALYZE する (無料)
L7 ANALYZE L6 TOP 10 : 10 TERMS

=> ANA L3 ICM.B ← 回答全件から ICM.B を ANALYZE する
L8 ANALYZE L3 1- ICM.B : 141 TERMS

=> ANA L8 TOP20 LEN4 ← さらに L8 の上位 20 位を先頭から 4 文字で ANALYZE する
L9 ANALYZE L8 TOP 20 LEN 4 : 6 TERMS (無料)

STN の統計解析機能

統計解析の表示

- ・ ANALYZE コマンドで統計解析した結果は、DISPLAY コマンドまたは TABULATE コマンドを使って表示する。
- ・ TABULATE コマンドと DISPLAY コマンドの特徴と料金

(2004 年 2 月現在)

	TABULATE コマンド	DISPLAY コマンド
特徴	<ul style="list-style-type: none">・ 2 つのフィールドを関連させた表示・ GRID 形式での表示・ 非 GRID 形式での表示・ DELIM 形式での表示/ダウンロード	<ul style="list-style-type: none">・ 1 フィールドでの表示・ DELIM 形式での表示/ダウンロード
使用できるファイル	HOME, STNGUIDE, NUMERIGUIDE, STNMAIL を <u>除く</u> すべてのファイル	制限なし
利用できないフィールド	PN (特許番号) AP (出願番号) RN (CAS 登録番号) AN (レコード番号) BI (基本索引中のターム)	制限なし
料金	4,140 円 / 回	無料



ANALYZE した結果を表示 (DISPLAY または TABULATE) するときは、同一ファイルでなくともよい。従って、接続時間料のかからないファイル (ZCA, ZCAplus など) で表示すると経済的である。

STN の統計解析機能

統計解析の表示 (DISPLAY コマンド)

・ DISPLAY コマンド (無料)

DISPLAY コマンドは D (1 文字) に省略できる。
省略しないと、初心者モードでの入力になる。(コマンド以外の入力は順不同)

=> D [ANALYZE した L 番号] [抽出フィールド] [表示範囲] [表示順序]
[表示オプション]

・ デフォルト

- ANALYZE した L 番号 : 直前の L 番号
- 抽出フィールド : 全フィールド
- 表示範囲 : 上位 10 ターム
- 表示順序 : 最初は出現頻度順 (OCC), 以降は直前の表示順序

・ 表示範囲

- 1- または ENTIRE : 全ターム
- ターム番号を指定 : 指定した範囲
- TOP n : 上位 n 位までのターム
- OGT n : 出現数 n 以上のターム
- DGT n : レコード数 n 以上のターム
- PGT n または %GT n : レコード数の全体に占める割合が n% 以上のターム

・ 表示順序 (ソートオプション)

- OCCURRENCE : 出現数順
- DOCUMENT : レコード数順
 - A (昇順) : レコード数の少ない順 (0→9)
 - D (降順) : レコード数の多い順 (9→0) (デフォルト)
- PERCENT または % : レコード数の全体に占める割合順
 - A (昇順) : 割合の少ない順 (0→100)
 - D (降順) : 割合の多い順 (100→0) (デフォルト)
- ALPHABETIC : アルファベット順
 - A (昇順) : A→Z、数字は小さい順 (0→9) (デフォルト)
 - D (降順) : Z→A、数字は大きい順 (9→0)

・ 表示オプション

- WITH "文字列" : 指定した文字列を含むタームのみ表示
- NOT "文字列" : 指定した文字列を含むタームを除いて表示
- ANSWER : 抽出前の回答集合中の回答番号を表示
- DETAIL : 検索フィールドをタームに付与して表示
- DELIMITED : デリミタ形式 (セミコロン (;) で区切る) で表示

・ 入力例 (p.19~24 参照)

- => D 1- ALP ← ANALYZE したターム全件をアルファベット順に表示
- => D PA TOP 10 ← ANALYZE した PA の上位 10 を出現頻度順に表示


STNの統計解析機能

統計解析の表示 (DISPLAY コマンド)

- 検索例 1 : 携帯電話のディスプレイに関する特許の出願人を統計解析する

=> FILE WPINDEX ← WPINDEX (会員は WPIDS/WPIX ファイル) に入る

=> SET PLU ON ← 複数形を自動的に含めて検索するよう指示
SET COMMAND COMPLETED

 L1 (6358 件) を表示することなく、回答セットから必要なフィールドを抽出し、統計解析ができる

=> SET ABB ON ← WPI の略語を自動的に含めて検索するよう指示
SET COMMAND COMPLETED

=> S (PERSONAL OR HANDY OR MOBILE) (S) TELEPHONE (S) DISPLAY

L1 6358 (PERSONAL OR HANDY) ← 特許出願人コードと出願人名 (PAX) を ANALYZE する

=> ANA L1 1- PAX
L2 ANALYZE L1 1- PA : 3152 TERMS 3152 ターム (PAX) が抽出された

=> FILE ZCA ← 接続時間料のかからない ZCA ファイルに切り替える

=> D
L2 ANALYZE L1 1- PAX : 3152 TERMS
DISPLAY コマンドで表示 (無料). 頻度の高い順 (OCC) に上位 10 位 (デフォルト) の PA が表示される.

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PAX
1	535	535	8.41	(SHIH) SEIKO EPSON CORP
2	370	370	5.82	(MATU) MATSUSHITA DENKI SANGYO KK
3	266	266	4.18	(SEME) SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
4	199	199	3.13	(NIDE) NEC CORP
5	185	185	2.91	(SHAF) SHARP KK
6	183	183	2.88	(TOKE) TOSHIBA KK
7	177	177	2.78	(SONY) SONY CORP
8	113	113	1.78	(HITA) HITACHI LTD
9	108	108	1.70	(MITQ) MITSUBISHI ELECTRIC CORP
10	101	101	1.59	(SIEI) SIEMENS AG

=> D 1- ← 全タームを表示するときは 1- とする
L2 ANALYZE L1 1- PAX : 3152 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PAX
1	535	535	8.41	(SHIH) SEIKO EPSON CORP
2	370	370	5.82	(MATU) MATSUSHITA DENKI SANGYO KK
3	266	266	4.18	(SEME) SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
4	199	199	3.13	(NIDE) NEC CORP
5	185	185	2.91	(SHAF) SHARP KK
6	183	183	2.88	(TOKE) TOSHIBA KK
7	177	177	2.78	(SONY) SONY CORP
8	113	113	1.78	(HITA) HITACHI LTD
9	108	108	1.70	(MITQ) MITSUBISHI ELECTRIC CORP
10	101	101	1.59	(SIEI) SIEMENS AG
11	97	97	1.53	(SAOL) SANYO ELEC
12	82	82	1.29	(PHIG) KONINK PHIL
13	81	81	1.27	(KYOC) KYOCERA CORP
14	78	78	1.23	(KOKZ) KOKUSAI DEN
: (途中省略)				
3150	1	1	0.02	(ZOND-1) ZONDERVAN
3151	1	1	0.02	HOME PTY LTD
3152	1	1	0.02	TRACK COMMUNICATIO

統計解析表示の見方
 TERM # : ターム番号
 # OCC : 頻度数
 # DOC : タームを含むレコード数
 % DOC : # DOC 数/全レコード数
 PAX : 抽出フィールド名

***** END OF L2 *****

STN の統計解析機能

統計解析の表示 (DISPLAY コマンド)

- 検索例 2 : BASF 社の 1993 年から 2003 年の特許出願分野を統計解析する

=> FILE WPINDEX

=> S (BASF/PA OR BADI/PACO) AND 1993-2003/PY.B

ベーシック特許の IPC 主分類の 前 4 文字 (サブクラス) とベーシック特許の発行年(PY.B) の 2 フィールドを ANALYZE する. (ANALYZE 料は 1 回分の課金)

L1 10202 (BASF/PA OR BADI/PACO) AND 1993-

=> ANA L1 1- ICM.B LEN 4 PY.B

L2 ANALYZE L1 1- ICM.B PY.B LEN 4 : 246 TERMS

=> FILE ZCA

接続時間料のかからない ZCA ファイルに切り替える

=> D

L2 ANALYZE L1 1- ICM.B PY.B LEN 4 : 246 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	ICM.B	PY.B
1	1451	1451	14.22	C07C	
2	1061	1061	10.40	2001	
3	1045	1045	10.24	1998	
4	1025	1025	10.05	1997	
5	1009	1009	9.89	1999	
6	1003	1003	9.83	2000	
7	979	979	9.60	2002	
8	977	977	9.58	C07D	
9	922	922	9.04	C08F	
10	895	895	8.77	C08G	

抽出された ICM.B と PY.B が 頻度の高い (OCC) 順に混ざって表示される

=> D ICM.B

ICM.B の上位 10 までを頻度の高い (OCC) 順に表示

L2 ANALYZE L1 1- ICM.B PY.B LEN 4 : 246 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	ICM.B	PY.B
1	1451	1451	14.22	C07C	
8	977	977	9.58	C07D	
9	922	922	9.04	C08F	
10	895	895	8.77	C08G	
16	711	711	6.97	C08L	
17	494	494	4.84	C09D	
18	344	344	3.37	A01N	
19	326	326	3.20	B01J	
20	301	301	2.95	C08J	
21	300	300	2.94	A61K	

=> D PY.B

PY.B の上位 10 までを頻度の高い (OCC) 順に表示

L2 ANALYZE L1 1- ICM.B PY.B LEN 4 : 246 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	ICM.B	PY.B
2	1061	1061	10.40	2001	
3	1045	1045	10.24	1998	
4	1025	1025	10.05	1997	
5	1009	1009	9.89	1999	
6	1003	1003	9.83	2000	
7	979	979	9.60	2002	
11	892	892	8.74	1996	
12	835	835	8.18	1993	
13	800	800	7.84	2003	
14	789	789	7.73	1995	

STN の統計解析機能

統計解析の表示 (TABULATE コマンド)

- ・ TABULATE コマンド (有料)

=> **TABULATE [ANALYZE した L 番号] [2 フィールドに関する指定]**

```
=> TABULATE L2 *1
  DISPLAY AS GRID FORMAT (N), Y, OR ? : Y *2
  ENTER PRIMARY DISPLAY CODE OR (?) : ICM.B
  ENTER SECONDARY DISPLAY CODE OR (?) : PY.B
  DISPLAY PRIMARY (TOP 10), ENTIRE OR ? : *3
  PRIMARY SORT ORDER (CURRENT), DOC, ALPHA, OR ? : DOC *4
  PRIMARY SORT DIRECTION (DEFAULT), A, D, OR ? : D
  SECONDARY SORT ORDER (CURRENT), DOC, ALPHA, OR ? : ALPHA
  SECONDARY SORT DIRECTION (DEFAULT), A, D, OR ? : A
  A FEE WILL BE CHARGED. PROCEED? (Y), N, OR ? : Y
L2          ANALYZE L1 1- ICM.B PY.B LEN 4 : 246 TERMS
```

GRID 形式の表示

PRIMARY CODE :
ICM.B
レコード数順 上位 10
降順
SECONDARY CODE :
PY.B
alpha numeric 順
昇順

実行の確認

PY. B

ICM.	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
C07C	108	100	114	142	132	144	141	167	137	143	123
C07D	86	75	79	102	115	113	91	101	99	67	49
C08F	103	68	74	73	115	111	100	72	86	72	48
C08G	67	73	66	96	74	76	97	83	97	87	79
C08L	94	64	61	68	75	85	78	81	54	22	29
C09D	17	28	40	30	51	33	46	62	73	66	48
A01N	12	7	22	15	53	47	46	35	23	49	35
B01J	12	8	16	25	36	27	31	39	38	52	42
C08J	30	19	20	25	35	35	34	20	28	35	20
A61K	5	11	7	20	18	46	45	48	51	25	24

GRID 形式

TERM #	# DOC	% DOC	ICM.B	PY.B
1	1455	14.16	C07C	
	108	1.05	--	1993
	100	0.97	--	1994
	114	1.11	--	1995
	142	1.38	--	1996
	132	1.28	--	1997
	144	1.40	--	1998
	141	1.37	--	1999
	167	1.63	--	2000
	137	1.33	--	2001
	143	1.39	--	2002
	123	1.24	--	2003
8	979	9.53	C07D	
	86	0.84	--	1993
	75	0.73	--	1994
	79	0.77	--	1995
	102	0.99	--	1996
115	1.12	--	1997	

非 GRID 形式

(以下省略)

STN の統計解析機能

統計解析の表示 (TABULATE コマンド)

続けて、デリミタ形式での二次元表示を指示。
(同一の TABULATE コマンド中で表示し直すことができる。
TABULATE 料の課金は 1 回分)

```
REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : TABULATE DELIM
DISPLAY AS GRID FORMAT (N), Y, OR ? : N
EXCHANGE PRIMARY AND SECONDARY DISPLAY FIELDS (N), Y, OR ? : 

DISPLAY PRIMARY (TOP 10), ENTIRE OR ? : 

DISPLAY SECONDARY (TOP 10), ENTIRE OR ? : 

PRIMARY SORT ORDER (CURRENT), DOC, ALPHA, OR ? : DOC
PRIMARY SORT DIRECTION (DEFAULT), A, D, OR ? : D
SECONDARY SORT ORDER (CURRENT), DOC, ALPHA, OR ? : ALPHA
SECONDARY SORT DIRECTION (DEFAULT), A, D, OR ? : A
L2          ANALYZE L1 1- ICM.B PY.B LEN 4 :      246 TERMS
```

GRID 形式ではない

PRIMARY フィールド^{*},
SECONDARY フィールド^{*}
の変更なし

```
108:1.06:C07C:1993
100:0.98:C07C:1994
114:1.12:C07C:1995
142:1.39:C07C:1996
132:1.29:C07C:1997
144:1.41:C07C:1998
141:1.38:C07C:1999
167:1.64:C07C:2000
137:1.34:C07C:2001
143:1.40:C07C:2002
86:0.84:C07D:1993
75:0.74:C07D:1994
79:0.77:C07D:1995
102:1.00:C07D:1996
115:1.13:C07D:1997
113:1.11:C07D:1998
91:0.89:C07D:1999
101:0.99:C07D:2000
99:0.97:C07D:2001
67:0.66:C07D:2002
103:1.01:C08F:1993
68:0.67:C08F:1994
74:0.73:C08F:1995
73:0.72:C08F:1996
115:1.13:C08F:1997
111:1.09:C08F:1998
100:0.98:C08F:1999
72:0.71:C08F:2000
86:0.84:C08F:2001
72:0.71:C08F:2002
:
(途中省略)
:
45:0.44:A61K:1999
48:0.47:A61K:2000
51:0.50:A61K:2001
25:0.25:A61K:2002
```

デリミタ 形式

このデータをコピーし、Excel で表やグラフにすることができる

TABULATE 表示の終了 *5

```
REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : END
```

=>

STN の統計解析機能

統計解析の表示 (TABULATE コマンド)

*1 コマンドオプション (TABULATE と同じコマンド行で指定)

- DELIMITED : デリミタ形式. MS Excel などの表計算ソフトウェアを利用してグラフを作成することができる.
- ANSWER : タームに回答番号を付与 (GRID 形式では不可)
- DETAIL : 検索フィールドを付与
- WITH "文字列" : 第一表示フィールドのタームの中で特定の文字を含むタームのみ解析
- NOT "文字列" : 第一表示フィールドのタームの中で特定の文字列を含むタームを除いて解析

指定例 => TABULATE DELIM

*2 GRID 形式を指定した場合, 第二表示フィールドは、自動的に全範囲となる.

*3 表示範囲

- 1- または ENTIRE : 全ターム
- TOP n : 上位 n 件までのターム (デフォルトは TOP 10)
- DGT n : レコード数 n 以上のターム
- PGT n または %GT n : レコード数の全体に占める割合が n % 以上のターム

*4 表示順序 (ソートオプション)

- DOCUMENT : レコード数順
- A (昇順) : レコード数の少ない順 (0→9)
 - D (降順) : レコード数の多い順 (9→0) (デフォルト)

- PERCENT または % : レコード数の全体に占める割合順
- A (昇順) : 割合の少ない順 (0→100)
 - D (降順) : 割合の多い順 (100→0) (デフォルト)

- ALPHABETIC : アルファベット順
- A (昇順) : A→Z, 数字は小さい順 (0→9) (デフォルト)
 - D (降順) : Z→A, 数字は大きい順 (9→0)

*5 最初に指定した 2 種のフィールドに対して表示形式を変えて何度でも統計解析表示することができる (追加料金なし). 続けて表示する場合は, ここで N ではなく Y または TABULATE <オプション> と入力する.

STN の統計解析機能

統計解析の表示 (TABULATE コマンド)

・ Excel でのグラフ作成手順

- ① Excel を起動したのち、デリミタ形式のデータをコピーし、Excel のシートに貼り付ける。
- ② データの区切りをセミコロンにする。
[データ] メニューから [区切り位置] を選択し、セミコロンを指定する。

The screenshot illustrates the steps to configure the Text Import Wizard in Excel:

- 区切り位置指定ウィザード - 1 / 3**: Selects the data source and chooses to import as '区切られたデータ' (Delimited).
- 区切り位置指定ウィザード - 2 / 3**: Specifies the '区切り文字' (List separator) as 'セミコロン(M)' (Semicolon).
- 区切り位置指定ウィザード - 3 / 3**: Specifies the '列のデータ形式' (Column data format) as 'G/標準(G)' (General).

The data preview in the wizard shows the following table:

1	108	1.06	C07C	1993
2	100	0.98	C07C	1994
3	114	1.12	C07C	1995
4	142	1.39	C07C	1996

STN の統計解析機能

統計解析の表示 (TABULATE コマンド)

- ③ 1 カラムのところにカーソルを合わせ、[挿入] メニューから行を選択し、1 行挿入する。
各データ項目名 (ここでは、レコード数、%, ICM.B, PY.B) を入力する。

	A	B	C	D	E
1	レコード数	%	ICM.B	PY.B	
2	108		1.06 C07C	1993	
3	100		0.98 C07C	1994	
4	114		1.12 C07C	1995	
5	142		1.39 C07C	1996	
6	132		1.29 C07C	1997	
7	144		1.41 C07C	1998	
8	141		1.38 C07C	1999	
9	167		1.64 C07C	2000	
10	137		1.34 C07C	2001	

- ④ ピボット形式に変換する。
[データ] メニューの [ピボットテーブルとピボットグラフ] を選択し、指示に従う。

Microsoft Excel

MS Pゴシック 11 B I U

Book1

レコード数

ピボットテーブルとピボットグラフ レポート...

ピボットテーブル/ピボットグラフ ウィザード - 1/3

分析するデータのある場所を選択してください。

- Excel のリスト/データベース (M)
- 外部データ ソース (E)
- 複数のワークシート範囲 (C)
- (ほかのピボットテーブルまたはピボットグラフ (A))

作成するレポートの種類を指定してください。

- ピボットテーブル (T)
- ピボットグラフ (ピボットテーブル付き) (R)

キャンセル < 戻る (B) 次へ > 完了 (F)

ピボットテーブル/ピボットグラフ ウィザード - 2/3

使用するデータの範囲を指定してください。

範囲 (R): \$A\$1:\$D\$101 参照 (W)...

キャンセル < 戻る (B) 次へ > 完了 (F)

STNの統計解析機能

統計解析の表示 (TABULATE コマンド)

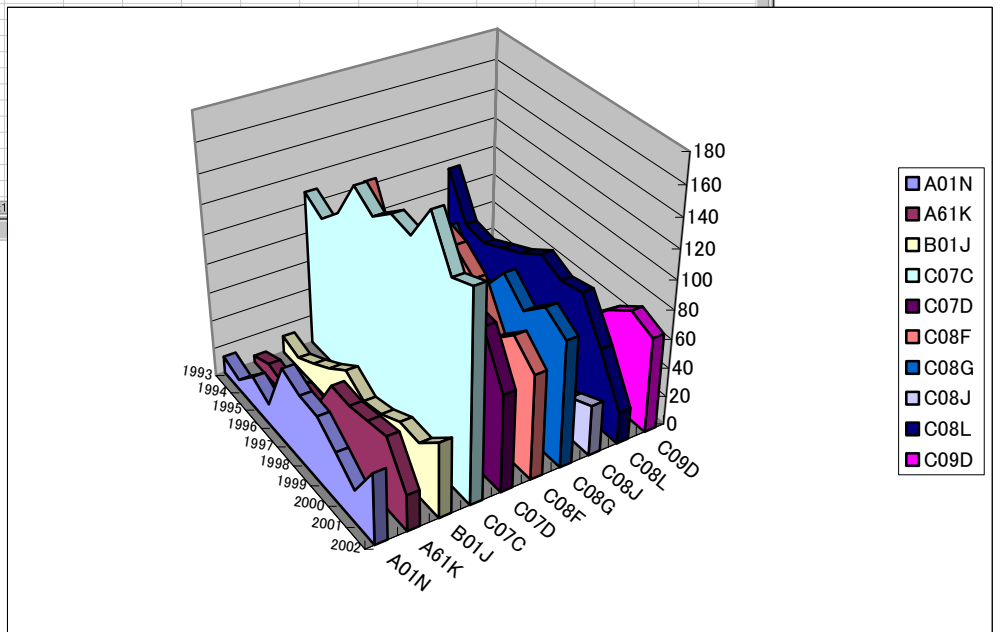
- ⑤ 表, グラフを作成したときの横軸, 縦軸になる項目を指定する。
 ここでは, 縦軸に PY.B, 横軸に ICM.B, 中央の部分にレコード数を指示する。
 ピボット形式の表が作成される。[グラフ] アイコンでグラフを作成する。

The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The PivotTable Wizard is open, showing the following configuration:

- ピボットテーブルの範囲: \$A\$3:\$M\$15
- レポートの表示形式: 表
- レコード数 (Count of ICM.B)

The resulting PivotTable is shown below:

		ICM.B										合計
		A01N	A61K	B01J	C07C	C07D	C08F	C08G	C08J	C08L	C09D	
合計:レコード数	PY.B	12	5	12	108	86	103	67	30	94	17	534
	1993	7	11	8	100	75	68	73	19	64	28	453
	1994	22	7	16	114	79	74	66	20	61	40	499
	1995	15	20	25	142	102	73	96	25	68	30	596
	1996	53	18	36	132	115	115	74	35	75	51	704
	1997	47	46	27	144	113	111	76	35	85	33	717
	1998	46	45	31	141	91	100	97	34	78	46	709
	1999	35	48	39	167	101	72	83	20	81	62	708
	2000	23	51	38	137	99	86	97	28	54	73	686
	2001	49	25	52	143	67	72	87	35	22	66	618
	2002											
合計		309	276	284	1328	928	874	816	281	682	446	6224



STN の統計解析機能

統計解析のときの注意点

- ① WPI (WPINDEX/WPIDS/WPIX) ファイルや CAplus/CA ファイルのレコードは、原則発明単位 (特許ファミリー単位) であるため、1 レコード中に複数の特許情報 (PN, PY, PD) が含まれている場合がある。これらのレコードで年や日を ANALYZE するときは、1 レコードから 1 データを抽出できるフィールド (PN.B, PY.B, PRYF など) を使用すれば発明単位での解析ができる。

=> FILE WPINDEX

=> S JP2001342110/PN
L1 1 JP2001342110/PN

=> D AN PI PRAI

```
L1 ANSWER 1 OF 1 WPINDEX COPYRIGHT 2004 THOMSON DERWENT on STN
AN 2002-114304 [15] WPINDEX Full-text
PI WO 2001091715 A2 20011206 (200215)* EN 53p A61K007-48
    .
    JP 2001342110 A 20011211 (200215) 19p A61K007-00 <--
    AU 2001067511 A 20011211 (200225) A61K007-48
    EP 1289489 A2 20030312 (200320) EN A61K007-48
    .
    KR 2003020289 A 20030308 (200345) A61K007-48
    US 2003198610 A1 20031023 (200370) A61K031-7048
PRAI JP 2000-165590 20000602
```

=> ANA L1 PY
L2 ANALYZE L1 1- PY : 2 TERMS

PY を ANALYZE すると
2 件となる。

=> D
L2 ANALYZE L1 1- PY : 2 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY
1	3	1	100.00	2001
2	3	1	100.00	2003

***** END OF L2 *****

=> ANA L1 PRYF
L3 ANALYZE L1 1- PRYF : 1 TERM

=> D
L3 ANALYZE L1 1- PRYF : 1 TERM

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PRYF
1	1	1	100.00	2000

***** END OF L3 *****

PRYF や PY.B の場合は
1 件となる。

=> ANA L1 PY.B
L4 ANALYZE L1 1- PY.B : 1 TERM

=> D
L4 ANALYZE L1 1- PY.B : 1 TERM

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY.B
1	1	1	100.00	2001

***** END OF L4 *****

STN の統計解析機能

統計解析のときの注意点

- ② 特許出願人名 (PA) の統計解析のときは, ANALYZE 後, EDIT COMBINE コマンドで会社名を統合させると, より正確な統計解析結果が得られる.
(検索例: 野依博士が共同研究している企業 (特許出願人) を CAPLUS ファイルで統計解析する)

=> FILE CAPLUS

=> D HIS NOFILE

FILE 'CAPLUS' ENTERED AT 10:30:50 ON 05 FEB 2004

E NOYORI R/AU
L1 681 SEA ("NOYORI R"/AU OR "NOYORI RYOJI"/AU OR "NOYORI RYORI"/AU
OR "NOYORI RYOZI"/AU OR "NOYORI RYOZJI"/AU)
L2 124 SEA L1 AND P/DT

PA を ANALYZE する

=> ANA L2 1- PA

L3 ANALYZE L2 1- PA : 58 TERMS

接続時間料のかからない ZCA ファイルに切り替えてから抽出された全タームをアルファベット順に表示する

=> FILE ZCA

=> D L3 1- ALPHA

L3 ANALYZE L2 1- PA : 58 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PA
1	1	1	0.81	AJINOMOTO CO INC JAPAN
2	2	2	1.61	ASAHI GLASS CO LTD JAPAN
3	1	1	0.81	ASAHI KASEI K K JAPAN
4	1	1	0.81	ASAHI KASEI KOGYO KABUSHIKI KAISHA
5	11	11	8.87	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
6	1	1	0.81	DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES LTD JAPAN
7	1	1	0.81	DAINIPPON INK AND CHEMICALS INC JAPAN
: (途中省略)				
40	4	4	3.23	SHINGIJUTSU KAIHATSU JIGYODAN JAPAN
41	3	3	2.42	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD JAPAN
42	8	8	6.45	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD
43	1	1	0.81	SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD
44	1	1	0.81	SUMITOMO KAGAKU KOGYO K K JAPAN
45	1	1	0.81	T HASEGAWA CO LTD
46	6	6	4.84	TAKASAGO INTERNATIONAL CORP JAPAN
47	1	1	0.81	TAKASAGO INTERNATIONAL CORP
48	2	2	1.61	TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION JAPAN
49	1	1	0.81	TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION
50	11	11	8.87	TAKASAGO PERFUMERY CO LTD JAPAN
51	2	2	1.61	TAKASAGO PERFUMERY CO LTD
52	1	1	0.81	TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD JAPAN
53	3	3	2.42	TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD
54	1	1	0.81	TAKEHARA JUN
55	28	28	22.58	TEIJIN LTD JAPAN
56	1	1	0.81	TOA GOSEI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD JAPAN
57	1	1	0.81	TOA GOSEI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD
58	1	1	0.81	TOA GOSEI KK JAPAN

***** END OF L3 *****

STN の統計解析機能

統計解析のときの注意点

=> EDIT COM L3

ENTER PREFERRED TERM NUMBER OR (?): 3
 PREFERRED TERM: ASAHI KASEI K K JAPAN/PA
 ENTER EQUIVALENT TERM NUMBERS OR (END): 4
 EQUIVALENT TERM: ASAHI KASEI KOGYO KABUSHIKI KAISHA/PA
 ENTER EQUIVALENT TERM NUMBERS OR (END): END
 APPLY CHANGES? (Y)/N: Y
 TERMS COMBINED

EDIT COMBINE コマンドを使って、
 同じ会社のタームを統合する。
 ここでは、旭化成の出願をまとめる。

=> EDIT COM L3

ENTER PREFERRED TERM NUMBER OR (?): 41
 PREFERRED TERM: SUMITOMO CHEMICAL CO LTD JAPAN/PA
 ENTER EQUIVALENT TERM NUMBERS OR (END): 42, 43, 44
 EQUIVALENT TERM: SUMITOMO CHEMICAL CO LTD/PA
 EQUIVALENT TERM: SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD/PA
 EQUIVALENT TERM: SUMITOMO KAGAKU KOGYO K K JAPAN/PA
 ENTER EQUIVALENT TERM NUMBERS OR (END): END
 APPLY CHANGES? (Y)/N: Y
 TERMS COMBINED

住友化学工業の出願をまとめる

=> EDIT COM L3

ENTER PREFERRED TERM NUMBER OR (?): 46
 PREFERRED TERM: TAKASAGO INTERNATIONAL CORP JAPAN/PA
 ENTER EQUIVALENT TERM NUMBERS OR (END): 47, 48, 49, 50, 51
 EQUIVALENT TERM: TAKASAGO INTERNATIONAL CORP/PA
 EQUIVALENT TERM: TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION JAPAN/PA
 EQUIVALENT TERM: TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION/PA
 EQUIVALENT TERM: TAKASAGO PERFUMERY CO LTD JAPAN/PA
 EQUIVALENT TERM: TAKASAGO PERFUMERY CO LTD/PA
 ENTER EQUIVALENT TERM NUMBERS OR (END): END
 APPLY CHANGES? (Y)/N: Y
 TERMS COMBINED
 : (途中省略)

高砂香料の出願をまとめる

=> D OCC 1-

L3 ANALYZE L2 1- PA : 58 TERMS
 (AFTER EDITS : 42 TERMS)

頻度順に全タームを表示し直す

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC PA	
1	28	28	22.58	TEIJIN LTD JAPAN
2@	23	23	18.55	TAKASAGO INTERNATIONAL CORP JAPAN
3@	13	13	10.48	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD JAPAN
4	11	11	8.87	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
5	9	9	7.26	FOUNDATION FOR SCIENTIFIC TECHNOLOGY PROMOTION JAPAN
6	9	9	7.26	NIPPON KOKAN CO LTD
7	8	8	6.45	NIPPON ZEON CO LTD JAPAN
8@	8	8	6.45	SANKYO CO LTD JAPAN
9	7	7	5.65	SEIKAGAKU KOGYO CO LTD JAPAN
10	5	5	4.03	IKARYA TAKAO
11	4	4	3.23	SHINGIJUTSU KAIHATSU JIGYODAN JAPAN
12@	4	4	3.23	TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD JAPAN
: (途中省略)				
41	1	1	0.81	T HASEGAWA CO LTD
42	1	1	0.81	TAKEHARA JUN

統合されたタームには @ が付く

***** END OF L3 *****

@ INDICATES TERMS AFFECTED BY MOST RECENT EDITS

STN の統計解析機能

統計解析表示の入力例

・ 表示範囲

・ 全ターム (1- または ENTIRE)

=> ANA L2 PA
L3 ANALYZE L2 1- PA : 567 TERMS

=> D 1-
L3 ANALYZE L2 1- PA : 567 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PA
1	82	82	14.94	SEIKO EPSON CORP
2	67	67	12.20	SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
3	44	44	8.01	NEC CORP
4	30	30	5.46	KONINK PHILIPS ELECTRONICS NV
5	23	23	4.19	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6	20	20	3.64	MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
7	19	19	3.46	MATSUSHITA DENKI SANGYO KK
8	16	16	2.91	PHILIPS GLOEILAMPENFAB NV
:				
566	1	1	0.18	ZHU Z
567	1	1	0.18	3M INNOVATIVE PROPERTIES CO

***** END OF L3 *****

・ ターム番号を指定 (m-n)

=> D 1-8
L3 ANALYZE L2 1- PA : 567 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PA
1	82	82	14.94	SEIKO EPSON CORP
2	67	67	12.20	SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
3	44	44	8.01	NEC CORP
4	30	30	5.46	KONINK PHILIPS ELECTRONICS NV
5	23	23	4.19	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6	20	20	3.64	MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
7	19	19	3.46	MATSUSHITA DENKI SANGYO KK
8	16	16	2.91	PHILIPS GLOEILAMPENFAB NV

・ 上位 n 位のターム (TOP n)

=> D TOP5
L3 ANALYZE L2 1- PA : 567 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PA
1	82	82	14.94	SEIKO EPSON CORP
2	67	67	12.20	SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
3	44	44	8.01	NEC CORP
4	30	30	5.46	KONINK PHILIPS ELECTRONICS NV
5	23	23	4.19	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

STN の統計解析機能

統計解析表示の入力例

・ 表示範囲 (続き)

- ・ 出現頻度数が n より多い (n は含まない) ターム (OGT_n)

=> D OGT 20

L3 ANALYZE L2 1- PA : 567 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC PA	
1	82	82	14.94	SEIKO EPSON CORP
2	67	67	12.20	SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
3	44	44	8.01	NEC CORP
4	30	30	5.46	KONINK PHILIPS ELECTRONICS NV
5	23	23	4.19	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

- ・ レコード数が n より多い (n は含まない) ターム (DGT_n)

=> D DGT 23

L3 ANALYZE L2 1- PA : 567 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC PA	
1	82	82	14.94	SEIKO EPSON CORP
2	67	67	12.20	SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
3	44	44	8.01	NEC CORP
4	30	30	5.46	KONINK PHILIPS ELECTRONICS NV

- ・ レコード数の全体に占める割合が n% より多い (n は含まない) ターム
(PGT_n または %GT_n)

=> D PGT 5

L3 ANALYZE L2 1- PA : 567 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC PA	
1	82	82	14.94	SEIKO EPSON CORP
2	67	67	12.20	SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
3	44	44	8.01	NEC CORP
4	30	30	5.46	KONINK PHILIPS ELECTRONICS NV

STN の統計解析機能

統計解析表示の入力例

・ 表示順序 (ソートオプション)

・ レコード数順 (DOCUMENT)

=> ANA L2 PY
L4 ANALYZE L2 1- PY : 16 TERMS

=> D DOC 1-5
L4 ANALYZE L2 1- PY : 16 TERMS

レコード数順
降順 D (大->小) (デフォルト)

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY
1	858	325	59.20	2003
2	765	262	47.72	2002
3	427	167	30.42	2001
4	219	90	16.39	2000
5	164	63	11.48	1999

=> D DOC A 1-5
L4 ANALYZE L2 1- PY : 16 TERMS

レコード数順
昇順 A (小->大)

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY
1	1	1	0.18	1992
2	2	1	0.18	1993
3	5	2	0.36	1995
4	7	3	0.55	1994
5	9	2	0.36	1990

・ 出現頻度順 (OCCURRENCE)

=> D OCC 1-5
L4 ANALYZE L2 1- PY : 16 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY
1	858	325	59.20	2003
2	765	262	47.72	2002
3	427	167	30.42	2001
4	219	90	16.39	2000
5	164	63	11.48	1999

・ レコード数の全体に占める割合順

=> D PER 1-5
L4 ANALYZE L2 1- PY : 16 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY
1	858	325	59.20	2003
2	765	262	47.72	2002
3	427	167	30.42	2001
4	219	90	16.39	2000
5	164	63	11.48	1999

STN の統計解析機能

統計解析表示の入力例

- ・ 表示順序 (ソートオプション) (続き)

- ・ アルファベット順 (ALPHABETIC)

=> D L3 ALP 1-5
L3 ANALYZE L2 1- PA : 567 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PA
1	1	1	0.18	ACHATZ J
2	1	1	0.18	ADACHI Y
3	1	1	0.18	AIDAN B
4	2	2	0.36	AKIBA M
5	5	5	0.91	ALCATEL ALSTHOM CIE GEN ELECTRICITE

文字列の場合はアルファベット順
(A -> Z)

=> D L4 ALP 1-5
L4 ANALYZE L2 1- PY : 16 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY
1	12	1	0.18	1989
2	9	2	0.36	1990
3	14	3	0.55	1991
4	1	1	0.18	1992
5	2	1	0.18	1993

数字の場合は数字順 (0 -> 9)

- ・ 表示オプション

- ・ タームに検索フィールドを付与

=> ANA L3 AP PRN
L5 ANALYZE L3 1- AP PRN : 1602 TERMS

=> D DET 1-20
L5 ANALYZE L3 1- AP PRN : 1602 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	AP PRN
1	5	1	0.18	W01998-JP1804/AP
2	5	1	0.18	W01998-JP3282/AP
3	3	1	0.18	EP1998-302045/AP
4	3	1	0.18	EP1998-306230/AP
5	3	1	0.18	JP1999-275250/AP
: (途中省略)				
13	2	2	0.35	JP1996-71872/PRN
14	2	2	0.35	JP1997-44382/AP
15	2	2	0.35	JP1998-31591/AP
16	2	2	0.35	JP1998-31591/PRN
17	2	2	0.35	JP2001-215612/PRN
18	2	2	0.35	JP2001-267693/AP
19	2	2	0.35	JP2001-267693/PRN
20	2	2	0.35	JP2001-303826/PRN

STNの統計解析機能

統計解析表示の入力例

・ 表示オプション (続き)

・ 指定した文字列を含むターム (WITH "文字列")

=> ANA L6 PN

L7 ANALYZE L6 1- PN : 9747 TERMS

=> D WITH "CN"

L7 ANALYZE L6 1- PN : 9747 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PN
5	2	2	0.03	CN1403856
461	1	1	0.02	CN1092578
462	1	1	0.02	CN1122585
463	1	1	0.02	CN1158064
464	1	1	0.02	CN1164909
465	1	1	0.02	CN1166711
466	1	1	0.02	CN1170140
467	1	1	0.02	CN1177268
468	1	1	0.02	CN1182338
469	1	1	0.02	CN1189737

516 MORE TERMS WITH AN OCCURRENCE COUNT OF 1

・ 指定した文字列を含むタームは除く (NOT "文字列")

=> D NOT "JP"

L7 ANALYZE L6 1- PN : 9747 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PN
1	3	1	0.02	EP417986
2	3	1	0.02	EP541772
3	3	1	0.02	EP661582
4	3	1	0.02	EP744727
5	2	2	0.03	CN1403856
6	2	2	0.03	FR2811133
8	2	2	0.03	US2002028697
9	2	1	0.02	CA2024702
10	2	1	0.02	CA2050803
11	2	1	0.02	CA2069230

124 MORE TERMS WITH AN OCCURRENCE COUNT OF 2

STN の統計解析機能

統計解析表示の入力例

- 表示オプション (続き)

- 回答番号付き (ANSWER)

=> D L3 OCC 1-2 ANS
L3 ANALYZE L2 1- PA : 567 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC PA	
1	82	82	14.94	SEIKO EPSON CORP (ANS: 7, 8, 14, 16, 20, 27, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 64, 65, 81, 82, 83, 95, 104, 108, 109, 110, 115, 123, 125, 137, 150, 156, 158, 170, 174, 179, 181, 182, 187, 188, 199, 203, 206, 209, 219, 220, 222, 225, 228, 232, 237, 247, 251, 258, 267, 278, 283, 284, 290, 292, 293, 294, 299, 305, 312, 322, 328, 330, 336, 362, 394, 424, 436, 467, 501, 504, 512, 514, 527)
2	67	67	12.20	SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (ANS: 2, 10, 12, 17, 24, 25, 28, 30, 33, 39, 47, 70, 71, 77, 78, 88, 93, 97, 100, 102, 106, 118, 119, 122, 127, 129, 134, 146, 161, 162, 183, 191, 210, 213, 217, 218, 229, 231, 233, 239, 240, 244, 255, 281, 282, 303, 313, 318, 326, 327, 331, 332, 333, 339, 344, 352, 360, 368, 374, 385, 388, 401, 403, 406, 413, 425, 426)

- デリミタ形式 (セミコロン (;) で区切る) で表示

=> D L3 OCC 1-10 DEL
L3 ANALYZE L2 1- PA : 567 TERMS

1;82;82;14.94;SEIKO EPSON CORP
2;67;67;12.20;SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
3;44;44;8.01;NEC CORP
4;30;30;5.46;KONINK PHILIPS ELECTRONICS NV
5;23;23;4.19;SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6;20;20;3.64;MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
7;19;19;3.46;MATSUSHITA DENKI SANGYO KK
8;16;16;2.91;PHILIPS GLOEILAMPENFAB NV
9;16;16;2.91;SHARP KK
10;16;16;2.91;YAMAZAKI S

STNの統計解析機能

EDIT コマンドのオプション

- ・ タイトル付与 : TITLE (TIT)

- ・ 統計解析した結果に対して、最大 100 文字までのタイトルを付与することができる。

=> **EDIT L3**

ENTER (CHANGE), COMBINE, OR TITLE: **TIT**

ENTER TITLE OR (END): **PATENT**

=> D OCC 1-5

PATENT

L3 ANALYZE L2 1- PA : 58 TERMS
 (AFTER EDITS : 41 TERMS)

TERM # # OCC # DOC % DOC PA

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PA
1	28	28	22.58	TEIJIN LTD JAPAN
2@	23	23	18.55	TAKASAGO INTERNATIONAL CORP JAPAN
3@	13	13	10.48	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD JAPAN
4	11	11	8.87	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
5	9	9	7.26	FOUNDATION FOR SCIENTIFIC TECHNOLOGY PROMOTION JAPAN

@ INDICATES TERMS AFFECTED BY MOST RECENT EDITS

- ・ タームの修正 : CHANGE (CHA)

- ・ ターム中の文字の訂正を行うことができる。

=> **EDIT L3**

ENTER (CHANGE), COMBINE, OR TITLE: **.**

ENTER TERM NUMBERS OR (ALL): **5**

ENTER STRING TO BE REPLACED OR (END): FOUNDATION FOR SCIENTIFIC TECHNOLOGY PROMOTION JAPAN

ENTER REPLACING STRING OR (NONE): JST

=> D OCC 1-5

PATENT

L3 ANALYZE L2 1- PA : 58 TERMS
 (AFTER EDITS : 41 TERMS)

TERM # # OCC # DOC % DOC PA

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PA
1	28	28	22.58	TEIJIN LTD JAPAN
2*	23	23	18.55	TAKASAGO INTERNATIONAL CORP JAPAN
3*	13	13	10.48	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD JAPAN
4	11	11	8.87	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
5@	9	9	7.26	JST

@ INDICATES TERM AFFECTED BY MOST RECENT EDITS

* INDICATES TERMS AFFECTED BY PREVIOUS EDITS

STN の統計解析機能

解析例 1 : 信越化学工業の技術動向調査

- ・ 解析例 1 : 信越化学工業の特許を解析して過去 10 年間の技術動向を調べる.
- ・ 使用ファイル : WPINDEX ファイル (会員用ファイルは WPIDS/WPIX ファイル), ZCA ファイル
- ・ 手順 ① 信越化学工業の特許レコードを検索して ANALYZE コマンドを実行する.
 - ② 特許件数の推移を見る.
 - ③ 国際特許分類 (IPC) で技術動向の推移を見る.
 - ④ ダウエントクラス (DC) で技術動向の推移を見る.
 - ⑤ どの国に特許を出願しているか.
 - ⑥ どの企業と共同出願しているか.

① 信越化学工業の特許レコードを検索して ANALYZE コマンドを実行する.

```
=> FILE WPINDEX                ← WPINDEX ファイルに入る
=> S SHIE/PACO OR ((SHINETSU OR SHIN(W)ETSU) (W) (CHEM? OR KAGAKU))/PA
    10725 SHIE/PACO                ↑
    (SHIE/PACO)                    信越化学工業の特許を検索する
    : 省略
L1  10725 SHIE/PACO OR ((SHINETSU OR SHIN(W)ETSU) (W) (CHEM? OR KAGAKU))/PA
=> S L1 AND 1994-2003/PY.B        ← Basic 特許が 1994~2003 年に発行されたレコードに限定する
    6100891 1994-2003/PY.B
L2  5433 L1 AND 1994-2003/PY.B
=> SAVE TEMP L2 SHINETSU/A        ← 回答セットを一時保存する (無料で一週間保存される)
ANSWER SET L2 HAS BEEN SAVED AS 'SHINETSU/A'
=> ANA L2 ICM.B LEN4 PY.B DC PC PAX ← 以下の項目で統計解析を実行する
ANALYZE IS APPROXIMATELY 11% COMPLETE * Basic 特許の国際特許分類 (サブクラスまで)
ANALYZE IS APPROXIMATELY 18% COMPLETE * Basic 特許の発行年
    : 省略                               * ダウエントクラス
ANALYZE IS APPROXIMATELY 89% COMPLETE * 特許発行国
ANALYZE IS APPROXIMATELY 95% COMPLETE * 出願人コード-出願人名
L3  ANALYZE L2 1- ICM.B PY.B DC PC PAX LEN 4 : 1029 TERMS
=> EDIT L3 TITLE                  ← 解析結果にタイトルをつける
ENTER TITLE OR (END):SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)
=> SAVE TEMP L3 SHINETSU1/Q        ← 解析結果を一時保存する (無料で一週間保存される)
QUERY L3 HAS BEEN SAVED AS 'SHINETSUWW1/Q' * 解析結果は /Q で保存する
```



統計解析に用いた回答セット (L2) や解析結果 (L3) を保存しておけば、後で呼び出して
① 解析結果を別の形式で表示したり (無料), ② 解析結果を更に解析したり (無料),
③ 回答セットを解析し直したり, ④ 統計的に興味のある回答レコードを表示したりすることが
できる。

STN の統計解析機能

解析例 1 : 信越化学工業の技術動向調査

③ 国際特許分類 (IPC) で技術動向の推移を見る。

=> D ICM.B

← 国際特許分類をレコード件数の多い順に上位 10 位まで表示する

SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)

L3 ANALYZE L2 1- ICM.B PY.B DC PC PAX LEN 4 : 1029 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	ICM.B	PY.B	DC	PC	PAX
12	703	703	12.94	C08L				
30	368	368	6.77	C08G				
31	364	364	6.70	G03F				
33	358	358	6.59	C07F				
36	340	340	6.26	C08F				
39	323	323	5.95	C03B				
44	231	231	4.25	G02B				
53	168	168	3.09	C09D				
55	162	162	2.98	H01L				
62	126	126	2.32	C04B				

C08L: 高分子化合物の組成物

C08G: 炭素-炭素不飽和結合のみが関与する反応以外の反応によって得られる高分子化合物

G03F: 炭素-炭素不飽和結合のみが関与する反応によって得られる高分子化合物

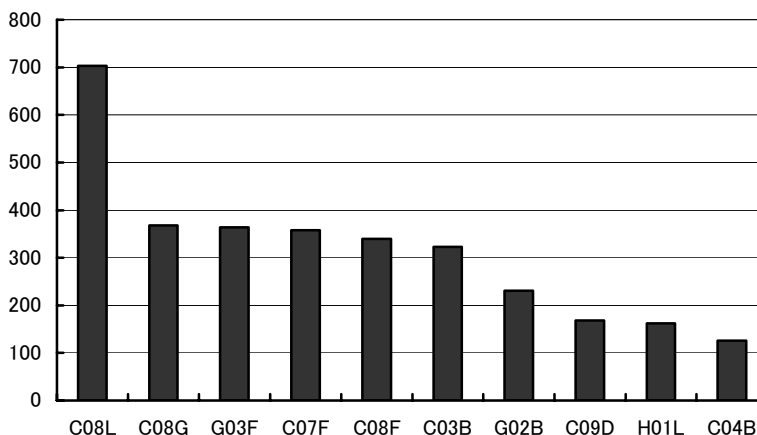
=> D ICM.B DELIM

← デリミタ形式で再表示すると MS Excel でグラフを作成できる

SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)

L3 ANALYZE L2 1- ICM.B PY.B DC PC PAX LEN 4 : 1029 TERMS

12:703:703:12.94:C08L
 30:368:368:6.77:C08G
 31:364:364:6.70:G03F
 33:358:358:6.59:C07F
 36:340:340:6.26:C08F
 39:323:323:5.95:C03B
 44:231:231:4.25:G02B
 53:168:168:3.09:C09D
 55:162:162:2.98:H01L
 62:126:126:2.32:C04B



=> TABULATE

ENTER ANALYZE OR SELECT L# (L3):L3
 DISPLAY AS GRID FORMAT (N), Y, OR ?:Y
 ENTER PRIMARY DISPLAY CODE OR (?):ICM.B
 ENTER SECONDARY DISPLAY CODE OR (?):PY.B
 DISPLAY PRIMARY (TOP 10), ENTIRE OR ?:TOP10
 PRIMARY SORT ORDER (CURRENT), DOC, ALPHA, OR ?:DOC
 PRIMARY SORT DIRECTION (DEFAULT), A, D, OR ?:D
 SECONDARY SORT ORDER (CURRENT), DOC, ALPHA, OR ?:ALP
 SECONDARY SORT DIRECTION (DEFAULT), A, D, OR ?:A
 A FEE WILL BE CHARGED. PROCEED? (Y), N, OR ?:Y

← TABULATE コマンドを入力する
 ← 解析結果の L 番号を指定する
 ← GRID 形式を指定する
 ← 縦軸を ICM.B にする
 ← 横軸を PY.B にする
 ← ICM.B の上位 10 位を表示する
 ← ICM.B の表示順序はレコード数順に指定
 ← レコード数の多い順にする
 ← PY.B は数値順にする
 ← PY.B は数値の小さい順にする
 ← 実行を指示する

STN の統計解析機能

解析例 1 : 信越化学工業の技術動向調査

SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)

L3 ANALYZE L2 1- ICM.B PY.B DC PC PAX LEN 4 : 1029 TERMS

PY.B

ICM.	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
C08L	102	83	94	78	64	59	75	47	62	39
C08G	56	56	49	45	25	25	21	35	33	23
G03F	40	27	43	33	35	18	33	54	51	30
C07F	62	77	58	39	28	24	12	21	26	11
C08F	76	44	45	36	17	15	25	31	42	9
C03B	14	23	21	11	23	24	76	68	30	33
G02B	9	9	33	28	34	37	13	37	8	23
C09D	18	28	20	20	13	13	12	20	16	8
H01L	12	19	14	11	7	21	17	21	31	9
C04B	26	14	21	21	10	5	11	6	5	7

GRID 形式の二次元表示は読みやすく、数値の推移を視覚的に把握できる。

ただし GRID 形式では横軸のデータ (PY.B) を範囲指定することができない (全データが指定される)。

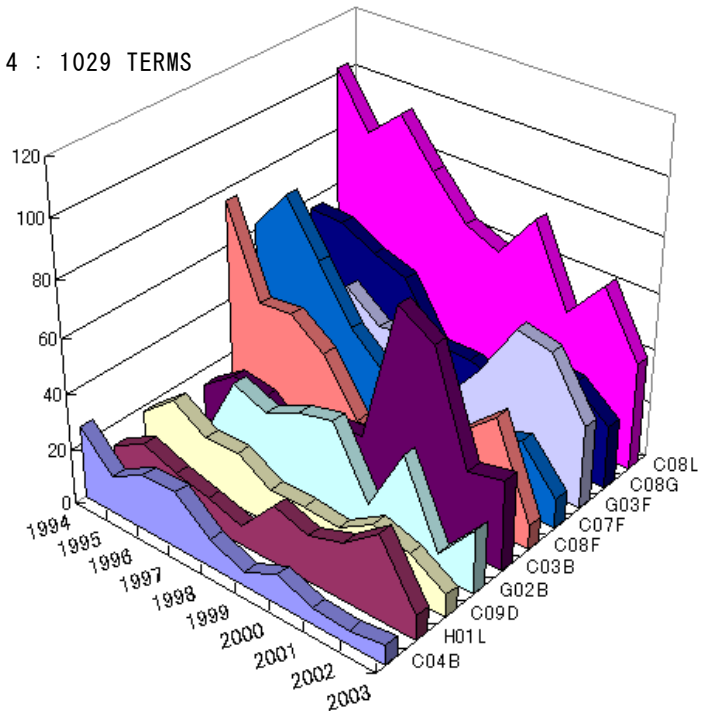
デリミタ形式で再表示すると MS Excel でグラフを作成できる ↓

REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : TAB DELIM ICM.B TOP10 DOC D PY.B 1- ALP A

SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)

L3 ANALYZE L2 1- ICM.B PY.B DC PC PAX LEN 4 : 1029 TERMS

102:1.88:C08L:1994
 83:1.53:C08L:1995
 94:1.73:C08L:1996
 78:1.44:C08L:1997
 64:1.18:C08L:1998
 : 省略
 5:0.09:C04B:2002
 7:0.13:C04B:2003



TABULATE コマンドは一行で指定することもできる。

=> TAB L3 DELIM ICM.B TOP10 DOC D PY.B 1- ALP A
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① 解析結果の L 番号 ② 形式 ③ 第一フィールド ④ 第一フィールドの表示範囲
- ⑤ 第一フィールドの表示順序 ⑥ 第一フィールドの表示方向 ⑦ 第二フィールド
- ⑧ 第二フィールドの表示範囲 ⑨ 第二フィールドの表示順序 ⑩ 第二フィールドの表示方向

STN の統計解析機能

解析例 1 : 信越化学工業の技術動向調査

REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : TAB ICM.B TOP10 DOC D PY.B 1- ALP A

SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)

↑
非 GRID 形式で再表示する

L3 SEL L2 1- ICM.B PY.B DC PC PAX LEN 4 : 1029 TERMS

TERM #	# DOC	% DOC	ICM.B	PY.B
12	703	12.94	C08L	
	102	1.88	--	1994
	83	1.53	--	1995
	94	1.73	--	1996
	78	1.44	--	1997
	64	1.18	--	1998
	59	1.09	--	1999
	75	1.38	--	2000
	47	0.87	--	2001
	62	1.14	--	2002
	39	0.72	--	2003
30	368	6.77	C08G	
	56	1.03	--	1994
	: 省略			
	6	0.11	--	2001
	5	0.09	--	2002
	7	0.13	--	2003

← 第一フィールド: Basic 特許の国際特許分類

第二フィールド: Basic 特許の発行年

非 GRID 形式では、第一フィールドに指定したデータの合計件数も表示される。

例: C08L は 703 件

非 GRID 形式やデリミタ形式では指定した 2 フィールド (ICM.B と PY.B) のデータを範囲指定することができる。

REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : TAB GRID PY.B 1- ALP A ICM.B DOC D

SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)

↑
縦軸と横軸を逆転して GRID 形式で表示する

L3 ANALYZE L2 1- ICM.B PY.B DC PC PAX LEN 4 : 1029 TERMS

ICM.B

PY.B	C08L	C08G	G03F	C07F	C08F	C03B	G02B	C09D	H01L	C04B	H01F	C01B	C08J	C30B	C07C
1994	102	56	40	62	76	14	9	18	12	26	13	15	14	12	10
1995	83	56	27	77	44	23	9	28	19	14	9	10	18	7	9
1996	94	49	43	58	45	21	33	20	14	21	10	17	13	17	20
1997	78	45	33	39	36	11	28	20	11	21	16	17	11	21	12
1998	64	25	35	28	17	23	34	13	7	10	20	17	5	7	11
1999	59	25	18	24	15	24	37	13	21	5	11	10	14	6	2
2000	75	21	33	12	25	76	13	12	17	11	20	4	8	5	5
2001	47	35	54	21	31	68	37	20	21	6	8	7	10	4	11
2002	62	33	51	26	42	30	8	16	31	5	13	8	12	13	8
2003	39	23	30	11	9	33	23	8	9	7	4	6	5	5	4

STN の統計解析機能

解析例 1 : 信越化学工業の技術動向調査

ICM.B

PY.B	H01M	A61K	C09J	G11B	C09K	B32B	C23C	C08B	G01N	C22C	B29C	C01F	G03G	C08K	B22F
1994	5	15	10	15	10	7	8	6	5	12	6	3	4	4	5
1995	4	4	12	15	8	6	10	5	9	6	9	12	6	5	7
1996	13	13	10	15	6	11	3	12	12	7	13	5	5	5	2
1997	12	12	7	19	11	3	6	5	8	1	5	8	5	5	1
1998	11	1	8	6	8	5	4	5	1	3	2	4	5	2	8
1999	6	11	5	3	6	2	3	3	3	4	6	4	3	4	7
2000	8	7	3	2	3	0	2	4	5	9	1	4	4	3	2
2001	10	8	7	0	2	3	3	6	2	1	2	5	6	6	3
2002	12	8	10	1	8	6	11	2	1	1	3	1	6	5	3
2003	9	7	5	0	4	11	2	2	4	5	1	1	3	5	4

: 省略

ICM.B

PY.B	H01C	H01G	H01P	H04B	H05F
1994	0	0	0	0	0
1995	0	1	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
1997	0	0	1	0	0
1998	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	1	0
2002	0	0	0	0	1
2003	1	0	0	0	0

GRID 形式では横軸データ (PY.B) は全て表示される (範囲指定できない).

横軸データが多い場合は、複数に分かれて表示される。

REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : TAB GRID ICM.B TOP5 DOC D PY.B ALP A

SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)

↑
縦軸を国際特許分類上位 5 位に変換して GRID 形式で表示する

L3 ANALYZE L2 1- ICM.B PY.B DC PC PAX LEN 4 : 1029 TERMS

PY.B

ICM.	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
C08L	102	83	94	78	64	59	75	47	62	39
C08G	56	56	49	45	25	25	21	35	33	23
G03F	40	27	43	33	35	18	33	54	51	30
C07F	62	77	58	39	28	24	12	21	26	11
C08F	76	44	45	36	17	15	25	31	42	9

縦軸データ (ICM.B) は全ての形式 (GRID, 非 GRID, デリミタ) で範囲指定することができる。

REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : END ← TABULATE コマンドを終了する



TABULATE コマンドは、最初に指定した 2 フィールドの二次元表示を :END で終了するまで、何度でも別の形式で表示することができる。この際の追加課金はない。

STN の統計解析機能

解析例 1 : 信越化学工業の技術動向調査

④ ダウエントクラス (DC) で技術動向の推移を見る。

=> D DC ← ダウエントクラスをレコード件数の多い順に上位 10 位まで表示する

SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)

L3 ANALYZE L2 1- ICM. B PY. B DC PC PAX LEN 4 : 1029 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	ICM. B PY. B DC PC PAX
3	1925	1925	35.43	L03
4	1524	1524	28.05	A26
7	1232	1232	22.68	U11
10	715	715	13.16	A85
14	646	646	11.89	V07
15	621	621	11.43	P84
16	616	616	11.34	P81
17	611	611	11.25	E11
18	601	601	11.06	G02
20	555	555	10.22	A89

L03: 以下の電気・無機・有機・化学的特性
コンダクタ, 抵抗, 磁石, キャパシター, スイッチ, 放電ランプ, 半導体, バッテリー, 蓄電池, ...以下省略.

A26: その他縮重合ポリマー

U11: 半導体材料および製法

A85: 電氣的応用

V07: ファイバー光学機器

P84: その他の写真技術

P81: 光学

E11: P および/または Si を含む.

G02: インキ, ペイント, 光沢剤

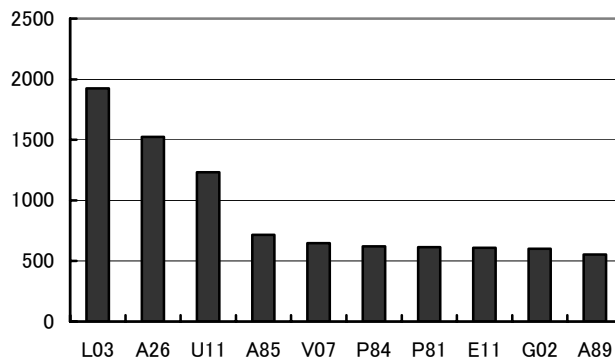
A89: 写真, 実験装置, 光学

=> D DC DELIM ← デリミタ形式で再表示すると MS Excel でグラフを作成できる

SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)

L3 ANALYZE L2 1- ICM. B PY. B DC PC PAX LEN 4 : 1029 TERMS

3;1925;1925;35.43;L03
 4;1524;1524;28.05;A26
 7;1232;1232;22.68;U11
 10;715;715;13.16;A85
 14;646;646;11.89;V07
 15;621;621;11.43;P84
 16;616;616;11.34;P81
 17;611;611;11.25;E11
 18;601;601;11.06;G02
 20;555;555;10.22;A89



STN の統計解析機能

解析例 1 : 信越化学工業の技術動向調査

=> TAB L3 GRID DC TOP10 DOC D PY.B ALP A ← GRID 形式でダウエントクラス上位 10 位までと特許発行年を二次元表示する

SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)

L3 ANALYZE L2 1- ICM.B PY.B DC PC PAX LEN 4 : 1029 TERMS

PY.B

DC	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
L03	272	220	231	179	159	156	177	200	210	121
A26	214	220	210	165	115	137	125	110	139	89
U11	165	125	137	110	102	93	85	153	174	88
A85	99	84	74	68	60	72	65	62	75	56
V07	30	49	74	53	63	49	95	111	55	67
P84	64	46	71	53	54	30	56	99	106	42
P81	38	40	75	55	74	65	76	82	54	57
E11	88	103	93	74	56	42	34	43	48	30
G02	74	89	75	61	48	63	58	56	51	26
A89	84	44	65	44	42	32	46	78	88	32

REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : TAB DELIM DC TOP10 DOC D PY.B 1- ALP A

SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)

↑
デリミタ形式で再表示すると MS Excel でグラフを作成できる

L3 ANALYZE L2 1- ICM.B PY.B DC PC PAX LEN 4 : 1029 TERMS

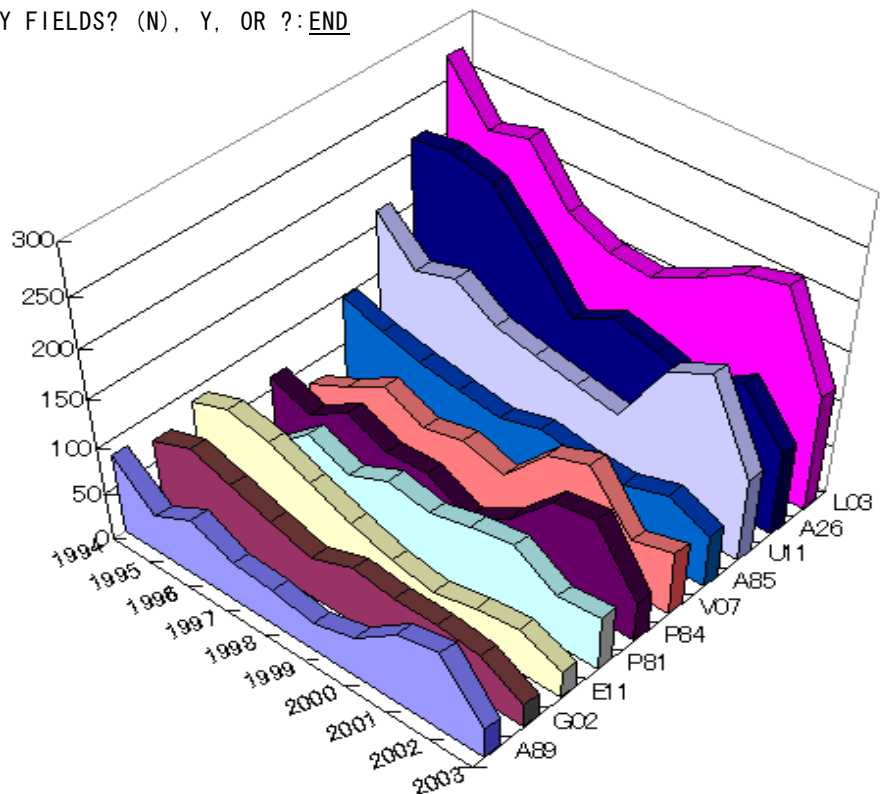
272:5.01:L03:1994

220:4.05:L03:1995

:省略

32:0.59:A89:2003

REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : END



STN の統計解析機能

解析例 1 : 信越化学工業の技術動向調査

⑤ どの国に特許を出願しているか.

=> D PC TOP15

← 特許発行国をレコード件数の多い順で上位 15 位まで表示する

SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)

L3 ANALYZE L2 1- ICM. B PY. B DC PC PAX LEN 4 : 1029 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	ICM. B	PY. B	DC	PC	PAX
1	7060	5357	98.60	JP				← 日本
6	1705	1449	26.67	US				← 米国
8	1148	766	14.10	EP				← ヨーロッパ特許
26	502	465	8.56	KR				← 韓国
39	325	316	5.82	DE				← ドイツ
46	232	225	4.14	TW				← 台湾
103	62	62	1.14	CN				← 中国
126	46	46	0.85	WO				← PCT 出願
142	42	34	0.63	CA				← カナダ
170	29	22	0.40	AU				← オーストラリア
219	13	13	0.24	SG				← シンガポール
225	17	11	0.20	GB				← イギリス
234	14	10	0.18	NO				← ノルウェー
253	9	9	0.17	ES				← スペイン
276	11	7	0.13	HU				← ハンガリー

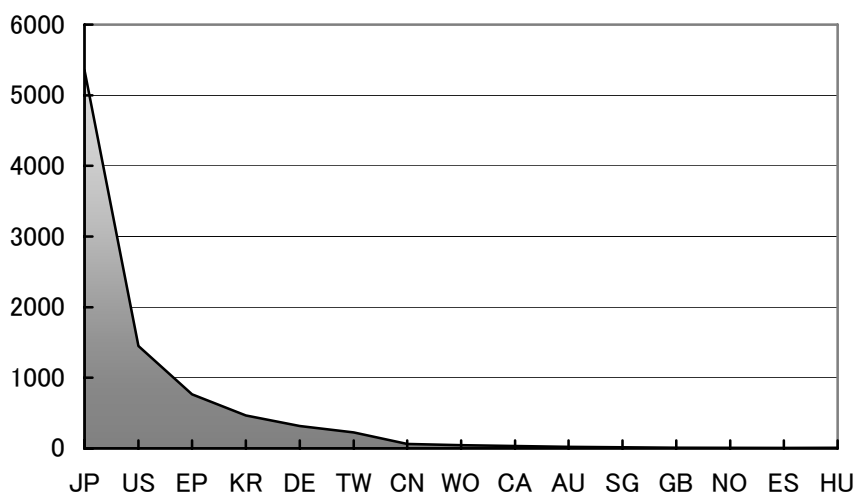
=> D PC DELIM TOP15

← デリミタ形式で再表示すると MS Excel でグラフを作成できる

SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)

L3 ANALYZE L2 1- ICM. B PY. B DC PC PAX LEN 4 : 1029 TERMS

1:7060;5357;98.60;JP
 6:1705;1449;26.67;US
 8:1148;766;14.10;EP
 : 省略



STN の統計解析機能

解析例 1 : 信越化学工業の技術動向調査

Optional Analysis

=> S L2 AND KRA/PK (S) 1994/PY ← 1994 年に発行された信越化学工業の韓国公開特許
 630193 KRA/PK
 601268 1994/PY
 0 KRA/PK (S) 1994/PY
 L4 0 L2 AND KRA/PK (S) 1994/PY

特定の国に発行された特許の
 発明件数を調べるためには、

=> S L2 AND KRA/PK (S) 1995/PY
 630193 KRA/PK
 669245 1995/PY
 0 KRA/PK (S) 1995/PY
 L5 0 L2 AND KRA/PK (S) 1995/PY
 : 省略

特許種別/PK (S) 発行年/PY
 を AND で組み合わせる。

=> S L2 AND KRA/PK (S) 2003/PY ← 2003 年に発行された信越化学工業の韓国特許
 630193 KRA/PK
 1190600 2003/PY
 75644 KRA/PK (S) 2003/PY
 L13 55 L2 AND KRA/PK (S) 2003/PY

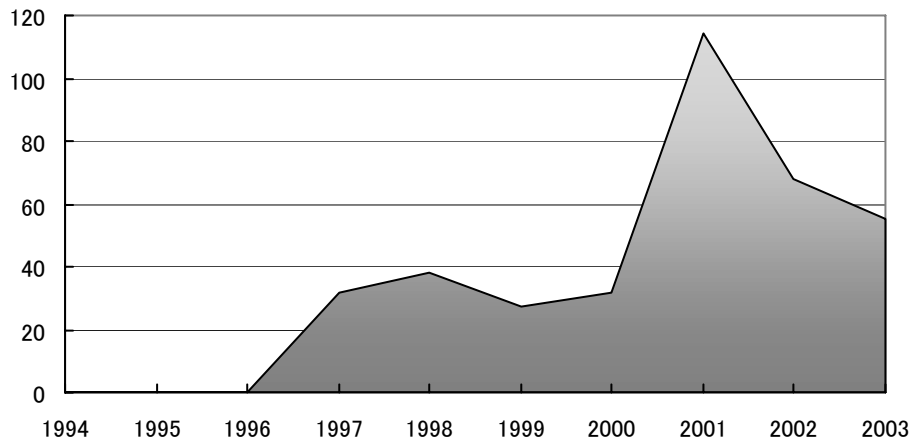
=> D HIS L4-L13 ← 検索の履歴を表示する

(FILE 'WPINDEX' ENTERED AT 19:56:53 ON 13 FEB 2004)
 EDIT L3 TITLE SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)

L4	0	S	L2	AND	KRA/PK	(S)	1994/PY
L5	0	S	L2	AND	KRA/PK	(S)	1995/PY
L6	0	S	L2	AND	KRA/PK	(S)	1996/PY
L7	32	S	L2	AND	KRA/PK	(S)	1997/PY
L8	38	S	L2	AND	KRA/PK	(S)	1998/PY
L9	27	S	L2	AND	KRA/PK	(S)	1999/PY
L10	32	S	L2	AND	KRA/PK	(S)	2000/PY
L11	114	S	L2	AND	KRA/PK	(S)	2001/PY
L12	68	S	L2	AND	KRA/PK	(S)	2002/PY
L13	55	S	L2	AND	KRA/PK	(S)	2003/PY

=> D HIS

などで表示された固定長のテキ
 ストデータは、MS Excel で取り
 込み、スペースでデータを区切
 ると、簡単に作表、グラフ化す
 ることができる。



STN の統計解析機能

解析例 1 : 信越化学工業の技術動向調査

⑥ どの企業と共同出願しているか。

=> D PAX TOP10 ← 出願人コード-出願人名 (PAX) をレコード件数の多い順に上位 10 位まで表示する

SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003)

L3 ANALYZE L2 1- ICM.B PY.B DC PC PAX LEN 4 : 1029 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	ICM.B	PY.B	DC	PC	PAX
2	5333	5333	98.16	(SHIE)	SHINETSU CHEM IND CO LTD	}		信越化学工業
5	1505	1502	27.65	(SHIE)	SHINETSU CHEM CO LTD			
61	128	128	2.36	(SHIE)	SHINETSU KAGAKU KOGYO KK			
121	47	47	0.87	(NITE)	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP			
136	38	38	0.70	(MATU)	MATSUSHITA DENKI SANGYO KK			
145	32	32	0.59	(SHHA)	SHINETSU HANDOTAI KK			
148	30	30	0.55	(GENG)	CENTRAL GLASS CO LTD			
155	28	28	0.52	(MENI-N)	MENICON CO LTD			← N つきのコードは固有のコードを持たない出願人
156	28	28	0.52	(SHIN-N)	SHINETSU BIO INC			
171	22	22	0.40	(UENO-I)	UENO S			← I つきのコードは個人出願

=> ANA L3 NOT "(SHIE)" ← 信越化学のデータを除く*

L4 ANALYZE L3 1- NOT "(SHIE)" : 1017 TERMS

=> ANA L4 NOT "-I)" ← 個人出願のデータを除く*

L5 ANALYZE L4 1- NOT "-I)" : 692 TERMS

=> D PAX ALP TOP10 ← PAX をアルファベット順で上位 10 位まで表示する

L5 ANALYZE L4 1- NOT "-I)" : 692 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	ICM.B	PY.B	DC	PC	PAX
1	2	2	0.04	(ADOM-N)	ADOMATEKKUSU KK	}		← 同じ出願人のデータが分かれていた
2	2	2	0.04	(ADOM-N)	ADOMATEX KK			
3	3	3	0.06	(AGEN)	AGENCY OF IND SCI & TECHNOLOGY			
4	2	2	0.04	(ALPS)	ALPS ELECTRIC CO LTD			
					: 省略			
10	1	1	0.02	(ASAH)	ASAHI KASEI KK			

=> EDIT L5 COMBINE

ENTER PREFERRED TERM NUMBER OR (?): 2

PREFERRED TERM: (ADOM-N) ADOMATEX KK/PAX

ENTER EQUIVALENT TERM NUMBERS OR (END): 1

EQUIVALENT TERM: (ADOM-N) ADOMATEKKUSU KK/PAX

ENTER EQUIVALENT TERM NUMBERS OR (END): END

APPLY CHANGES? (Y)/N: Y

TERMS COMBINED

← 出願人データを統合する

← 優先して残す出願人データのターム番号

← 統合後に消える出願人データのターム番号



ANALYZE コマンドで統計解析した結果は、更に ANALYZE や SELECT コマンドで処理して、タームを抽出することができる。この際の追加課金はない。

STN の統計解析機能

解析例 1 : 信越化学工業の技術動向調査

=> D PAX ALP TOP10 ← 再度 PAX をアルファベット順で上位 10 位まで表示する
 L5 ANALYZE L4 1- NOT "-1" : 692 TERMS
 (AFTER EDITS : 691 TERMS)

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	ICM. B	PY. B	DC	PC	PAX
1@	4	4	0.07	(ADOM-N)	ADOMATEX	KK		← 出願人データが統合された
2	3	3	0.06	(AGEN)	AGENCY OF IND SCI & TECHNOLOGY			
3	2	2	0.04	(ALPS)	ALPS ELECTRIC CO LTD			← 同じ出願人のデータが分かれていた
4	1	1	0.02	(ALPS)	ALPS ELECTRONIC CO LTD			
5	2	2	0.04	(AMAN)	AMANO PHARM	KK		
6	1	1	0.02	(ARUB-N)	ARUBO CO	KK		
7	1	1	0.02	(ASAG)	ASAHI GLASS CO	LTD		
8	1	1	0.02	(ASAH)	ASAHI CHEM IND CO	LTD		
9	1	1	0.02	(ASAH)	ASAHI KASEI	KK		
10	2	2	0.04	(ASAH)	ASAHI KASEI KOGYO	KK		

@ INDICATES TERM AFFECTED BY MOST RECENT EDITS

=> EDI L5 COMBINE 3 4 ← 出願人データを統合する*
 PREFERRED TERM: (ALPS) ALPS ELECTRIC CO LTD/PAX
 EQUIVALENT TERM: (ALPS) ALPS ELECTRONIC CO LTD/PAX
 APPLY CHANGES? (Y)/N:Y
 TERMS COMBINED

=> D PAX ALP TOP10 ← 再度 PAX をアルファベット順で上位 10 位まで表示する
 L5 ANALYZE L4 1- NOT "-1" : 692 TERMS
 (AFTER EDITS : 690 TERMS)

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	ICM. B	PY. B	DC	PC	PAX
1*	4	4	0.07	(ADOM-N)	ADOMATEX	KK		
2	3	3	0.06	(AGEN)	AGENCY OF IND SCI & TECHNOLOGY			
3@	3	2	0.04	(ALPS)	ALPS ELECTRIC CO LTD			← 出願人データが統合された
4	2	2	0.04	(AMAN)	AMANO PHARM	KK		
5	1	1	0.02	(ARUB-N)	ARUBO CO	KK		
6	1	1	0.02	(ASAG)	ASAHI GLASS CO	LTD		
7	1	1	0.02	(ASAH)	ASAHI CHEM IND CO	LTD		
8	1	1	0.02	(ASAH)	ASAHI KASEI	KK		
9	2	2	0.04	(ASAH)	ASAHI KASEI KOGYO	KK		
10	1	1	0.02	(AWAJ-N)	AWAJI SANGYO	KK		

@ INDICATES TERM AFFECTED BY MOST RECENT EDITS

* INDICATES TERM AFFECTED BY PREVIOUS EDITS

: 省略



解析結果は EDIT コマンドで解析することで、解析の精度を上げることができる。

EDIT COMBINE コマンドは一行で指定することもできる。

=> EDIT 解析結果の L 番号 COM 優先タームの番号 非優先タームの番号

STN の統計解析機能

解析例 1 : 信越化学工業の技術動向調査

=> D PAX ALP 130-140

L5 ANALYZE L4 1- NOT "-I)" : 692 TERMS
(AFTER EDITS : 648 TERMS)

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	ICM. B	PY. B	DC	PC	PAX
130	1	1	0.02	(SANN)	SANYO	CHEM	IND	LTD
131	1	1	0.02	(SAOL)	SANYO	ELECTRIC	CO	LTD
132*	2	2	0.04	(SEIK-N)	SEIKI	TOKYU	KOGYO	KK
133	2	2	0.04	(SEKI)	SEKISUI	CHEM	IND	CO LTD
134*	43	37	0.68	(SHHA)	SHINETSU	HANDOTAI	KK	
135	1	1	0.02	(SHIM-N)	SHIMA	DENSHI	KK	
136	3	3	0.06	(SHIN-N)	SHIN-ETSU	CO	LTD	
137	1	1	0.02	(SHIN-N)	SHIN-ETSU	SILICONES	AMERICA	
138	2	2	0.04	(SHIN-N)	SHIN-ETU	CHEM	CO	LTD
139*	29	29	0.53	(SHIN-N)	SHINETSU	BIO	INC	
140@	13	11	0.20	(SHIN-N)	SHINETSU	ENG	CO	LTD

← 信越化学工業関連
の出願人データ

@ INDICATES TERM AFFECTED BY MOST RECENT EDITS

* INDICATES TERMS AFFECTED BY PREVIOUS EDITS

=> ANA L5 NOT "SHINETSU"

L6 ANALYZE L5 1- NOT "SHINETSU" : 641 TERMS

← 信越化学工業関連の出願人データを除く

=> ANA L6 NOT "SHIN-ETSU"

L7 ANALYZE L6 1- NOT "SHIN-ETSU" : 639 TERMS

: 省略

=> D PAX DOC TOP10

L7 ANALYZE L6 1- NOT "SHIN-ETSU" : 639 TERMS
(AFTER EDITS : 628 TERMS)

← 編集後の PAX をレコード件数の多い順に上位 10 位まで表示する

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	ICM. B	PY. B	DC	PC	PAX
111	58	51	0.94	(NITE)	NIPPON	TELEGRAPH &	TELEPHONE	CORP
133	54	39	0.72	(MATU)	MATSUSHITA	DENKI	SANGYO	KK
144	30	30	0.55	(GENG)	CENTRAL	GLASS	CO	LTD
151	28	28	0.52	(MENI-N)	MENICON	CO	LTD	
181	19	19	0.35	(HITD)	HITACHI	CABLE	LTD	
188*	20	16	0.29	(TKEL)	TOKYO	ELECTRON	LTD	
189	16	16	0.29	(TAKE)	TAKEDA	CHEM	IND	LTD
217	11	11	0.20	(NISV)	NISSHIN	CHEM	IND	CO LTD
239	9	8	0.15	(NIPG)	NIPPON	SHEET	GLASS	CO LTD
240	8	8	0.15	(FURU)	FURUKAWA	ELECTRIC	CO	LTD

* INDICATES TERM AFFECTED BY PREVIOUS EDITS

=> D PAX DOC TOP10 DELIM

L8 ANALYZE L7 1- NOT "SHIN-ETSU" : 639 TERMS
(AFTER EDITS : 628 TERMS)

← デリミタ形式で再表示すると MS Excel でグラフを作成できる

111:58:51:0.94; (NITE) NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP

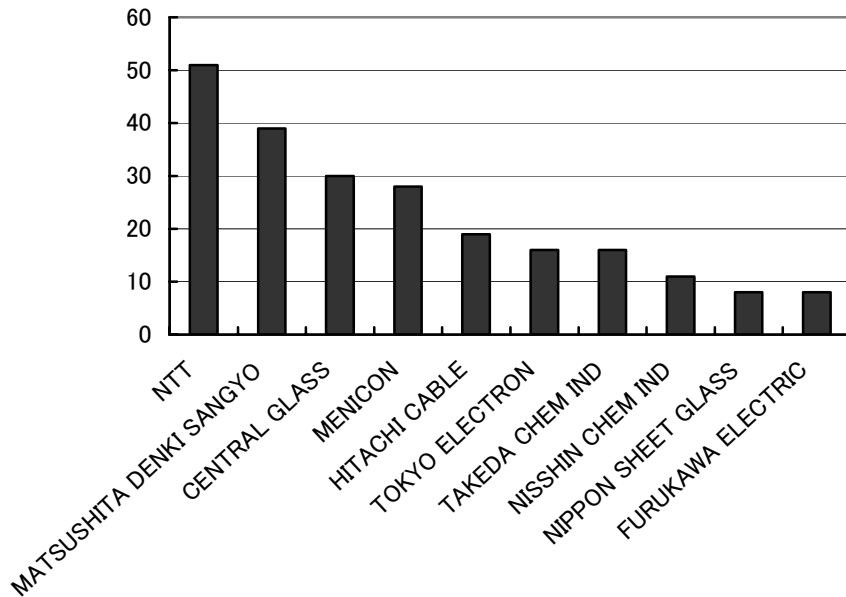
133:54:39:0.72; (MATU) MATSUSHITA DENKI SANGYO KK

144:30:30:0.55; (GENG) CENTRAL GLASS CO LTD

: 省略

STN の統計解析機能

解析例 1 : 信越化学工業の技術動向調査



=> EDIT L8 TITLE
 ENTER TITLE OR (END) : SHINETSU KAGAKU PATENT (1994-2003) AFTER EDITING PAX

=> SAVE TEMP L8 SHINETSU2/Q
 QUERY L8 HAS BEEN SAVED AS 'SHINETSUWW2/Q'

=> D_COS_FUL ← 課金状況を詳細表示する

FILE & COST CENTER	QUANTITY @	RATE	ESTIMATED COST JAPANESE YEN
HOME FILE COST=			
CONNECT HOURS	0.01 @	2100	21
INTERNET HOURS	0.01 @	800	8
WPINDEX FILE COST=			
CONNECT HOURS	0.11 @	44700	4917
INTERNET HOURS	0.11 @	700	77
ANALYZE LEVEL 2	1 @	2400	2400
ZCA FILE COST=			
SFE CONNECT HOURS	1.09 @	0	0
INTERNET HOURS	1.09 @	800	872
TABULATE EXECUTIONS	2 @	4140	8280

SUMMARY BY FILE	AND	COST CENTER	HOURS	ESTIMATED COST JAPANESE YEN
HOME FILE		(NONE)	0.01	29
WPINDEX FILE		(NONE)	0.11	7394
ZCA FILE		(NONE)	1.09	13292

COSTS INCLUDE TELECOMMUNICATION FEES 1.21 957

SUMMARY BY	COST CENTER	HOURS	ESTIMATED COST JAPANESE YEN
	(NONE)	1.21	16575
YOUR TOTAL SESSION COSTS ARE		1.21	16575

STN の統計解析機能

解析例 2 : 信越化学工業のポリマー分野の技術動向調査

- ・ 解析例 2 : 信越化学工業のポリマー分野の特許を解析して過去 10 年間の技術動向を調べる.
- ・ 使用ファイル : WPINDEX ファイル (会員用ファイルは WPIDS/WPIX ファイル), ZCA ファイル
DPCI ファイル, HCAPLUS ファイル, REGISTRY ファイル
- ・ 手順 ① 信越化学工業の特許レコードをポリマー分野に限定し ANALYZE コマンドを実行する.
② ポリマー分野の特許発行件数の推移を見る.
③ ダウエントクラス (DC) でポリマー分野の技術動向の推移を見る.
④ マニュアルコード (MC) でポリマー分野の技術動向の推移を見る.
⑤ ポリマー分野の特許の特許番号をリストアップする.
⑥ 信越化学工業ではどのようなポリマーを研究しているか.

① 信越化学工業の特許レコードをポリマー分野に限定し ANALYZE コマンドを実行する.

```
=> FILE WPINDEX          ← WPINDEX ファイルに入る

=> D SAVED              ← 保存してある回答セット, 解析結果, 質問式のリストを表示する
NAME                   CREATED          NOTES/TITLE
-----
SHINETSU/A            TEMP          5433 ANSWERS IN FILE WPINDEX
SHINETSU1/Q           TEMP          QUERY CREATED IN FILE WPINDEX
SHINETSU2/Q           TEMP          QUERY CREATED IN FILE WPINDEX

=> ACT SHINETSU/A      ← 解析例 1 で保存した回答セットを呼び出す
L1 ( 10725)SEA FILE=WPINDEX SHIE/PACO OR ((SHINETSU OR SHIN(W)ETSU) (W) (C
L2 5433 SEA FILE=WPINDEX L1 AND 1994-2003/PY. B
      ↑
      Basic 特許が 1994~2003 年に発行された信越化学工業の特許レコード

=> S L2 AND A/DC      ← ダウエントセクション A でポリマー分野の特許に限定する
      1749522 A/DC
L3 3228 L2 AND A/DC

=> ANA L3 PY. B DC MC PN ← 以下の項目で統計解析を実行する
      : 省略
L4 ANALYZE L3 1- PY. B DC MC PN : 9668 TERMS
      * Basic 特許の発行年
      * ダウエントクラス
      * マニュアルコード
      * 特許番号

=> EDIT L4 TITLE
ENTER TITLE OR (END) : SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

=> SAVE L4 SHINETSU3/Q
QUERY L4 HAS BEEN SAVED AS 'SHINETSU3/Q'
```

STN の統計解析機能

解析例 2 : 信越化学工業のポリマー分野の技術動向調査

② ポリマー分野の特許件数の推移を見る。

=> FILE ZCA

← 接続時間料の無料のファイルに入り解析結果を表示する

=> D PY.B ALP 1-

← 特許の発行年を数値順に全て表示する

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 ANALYZE L3 1- PY.B DC MC PN : 9668 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY. B	DC	MC	PN
9659	511	511	15.83	1994			
9660	442	442	13.69	1995			
9661	441	441	13.66	1996			
9662	355	355	11.00	1997			
9663	241	241	7.47	1998			
9664	234	234	7.25	1999			
9665	236	236	7.31	2000			
9666	275	275	8.52	2001			
9667	310	310	9.60	2002			
9668	183	183	5.67	2003			

← 網掛け部分のデータで特許件数の推移を見る

***** END OF L4 *****

=> D PY.B ALP DELIM 1-

← デリミタ形式で再表示すると MS Excel でグラフを作成できる

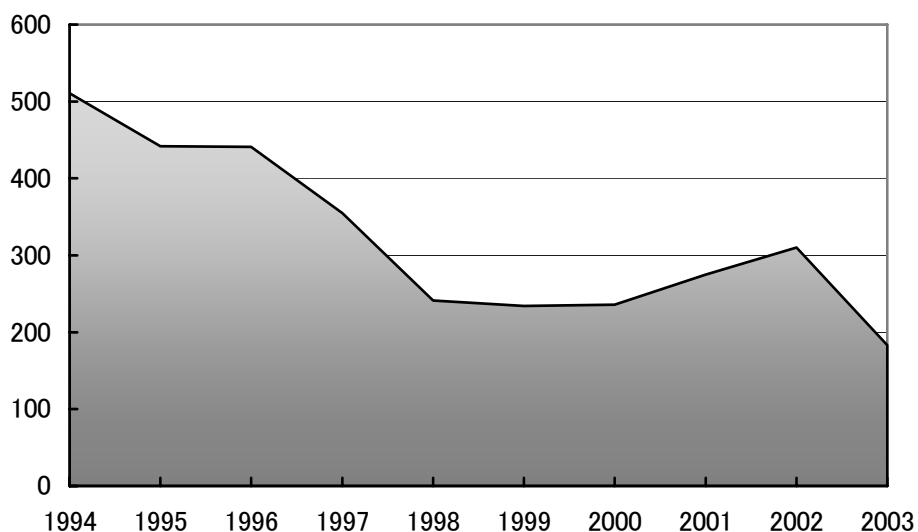
SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 ANALYZE L3 1- PY.B DC MC PN : 9668 TERMS

9659;511;511;15.83;1994

9660;442;442;13.69;1995

: 省略



STN の統計解析機能

解析例 2 : 信越化学工業のポリマー分野の技術動向調査

③ ダウエントクラス (DC) でポリマー分野の技術動向の推移を見る。

=> D DC DOC TOP20 WITH "A"

← セクション A に属するポリマー分野のダウエントクラス (DC) 上位 20 位まで表示する

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 SEL L3 1- PY.B DC MC PN : 9668 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY. B	DC	MC	PN
1	1524	1524	47.21	A26			
3	715	715	22.15	A85			
6	555	555	17.19	A89			
8	488	488	15.12	A14			
16	360	360	11.15	A82			
24	269	269	8.33	A21			
35	229	229	7.09	A60			
36	228	228	7.06	A96			
46	182	182	5.64	A25			
47	182	182	5.64	A97			
56	147	147	4.55	A11			
58	141	141	4.37	A93			
61	138	138	4.28	A81			
65	133	133	4.12	A13			
73	110	110	3.41	A88			
77	103	103	3.19	A41			
86	94	94	2.91	A32			
89	91	91	2.82	A18			
122	65	65	2.01	A23			
125	63	63	1.95	A17			

- ← その他縮合ポリマー
- ← ポリマーの応用: 電氣的応用
- ← ポリマーの応用: 写真, 実験装置, 光学
- ← その他の置換モノオレフィン
- ← ポリマーの応用: コーティング, 含浸, 艶出し
- ← エポキシ化合物, アミノプラスト, フェノプラスト
- ← 添加物および配合剤
- ← ポリマーの応用: 獣医薬, 医薬品, 歯科
- ← ポリウレタン, ポリエーテル
- ← ポリマーの応用: その他の特定されない商品
- ← 多糖類, 天然ゴム, 天然ポリマー
- ← ポリマーの応用: 道路, 建築, 構築, 床
- ← ポリマーの応用: 接着剤および結合剤
- ← 芳香族モノオレフィン
- ← ポリマーの応用: 機械工学および道具
- ← モノマーおよび縮重合原料
- ← ポリマーの加工
- ← 一般の付加ポリマー
- ← ポリアミド, ポリエステル
- ← 非置換脂肪族モノオレフィン

=> D DC DOC WITH "A8" 1-

← ポリマーの応用に関する A8 で始まるダウエントクラスを全て表示する

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 ANALYZE L3 1- PY.B DC MC PN : 9668 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY. B	DC	MC	PN
3	715	715	22.15	A85			
6	555	555	17.19	A89			
16	360	360	11.15	A82			
61	138	138	4.28	A81			
73	110	110	3.41	A88			
173	40	40	1.24	A87			
414	13	13	0.40	A84			
591	8	8	0.25	A83			
737	6	6	0.19	A86			

- ← 電氣的応用
- ← 写真, 実験装置, 光学
- ← コーティング, 含浸, 艶出し
- ← 接着剤および結合剤
- ← 機械工学および道具
- ← 繊維補助
- ← 家具, 事務用具, 室内装飾品
- ← 衣類, 履物
- ← 趣味用品, ゲーム, スポーツ, 玩具

STN の統計解析機能

解析例 2 : 信越化学工業のポリマー分野の技術動向調査

=> D DC DOC WITH "A9" 1- ← ポリマーの応用に関する A9 で始まるダウエントクラスを全て表示する

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 ANALYZE L3 1- PY. B DC MC PN : 9668 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY. B	DC	MC	PN
36	228	228	7.06	A96			
47	182	182	5.64	A97			
58	141	141	4.37	A93			
148	53	53	1.64	A92			
150	51	51	1.58	A95			
262	22	22	0.68	A94			
1428	2	2	0.06	A91			

← 獣医薬, 医薬品, 歯科
 ← その他の特定されない商品
 ← 道路, 建築, 構築, 床
 ← 包装および容器
 ← 輸送
 ← 半製品(繊維, フィルム, 泡)
 ← イオン交換樹脂, 高分子電解質

=> TAB L4 GRID DC WITH "A8" DOC D DGT30 PY. B ALP A ← 30 より多くのレコード (DGT30) に付与されている A8 で始まる (WITH "A8") ダウエントクラス (DC) と特許発行年 (PY.B) を GRID 形式で二次元表示する

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 SEL L3 1- PY. B DC MC PN : 9668 TERMS

PY. B

DC	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
A85	99	84	74	68	60	72	65	62	75	56
A89	84	44	65	44	42	32	46	78	88	32
A82	39	50	43	39	31	37	38	40	27	16
A81	20	28	11	16	7	8	14	13	16	5
A88	17	13	10	9	9	8	9	10	11	14
A87	5	4	4	7	2	5	5	6	2	0

REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : TAB GRID DC WITH "A9" DOC D DGT30 PY. B ALP A

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 SEL L3 1- PY. B DC MC PN : 9668 TERMS

PY. B

DC	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
A96	33	22	26	32	12	19	21	25	19	19
A97	19	18	23	21	19	15	10	13	24	20
A93	29	15	20	18	12	13	11	9	8	6
A92	9	7	12	14	1	3	2	1	2	2
A95	9	7	5	0	3	7	5	7	4	4

↑
 A9 で始まるダウエントクラスについても同様に表示する

STN の統計解析機能

解析例 2 : 信越化学工業のポリマー分野の技術動向調査

REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : TAB DELIM DC WITH "A8" DOC D DGT30 PY. B ALP
A

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 SEL L3 1- PY. B DC MC PN : 9668 TERMS

99:3.07;A85;1994

84:2.60;A85;1995

: 省略

↑
 デリミタ形式で再表示すると MS Excel
 でグラフを作成できる

REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : TAB DELIM DC WITH "A9" DOC D DGT30 PY. B ALP
A

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 SEL L3 1- PY. B DC MC PN : 9668 TERMS

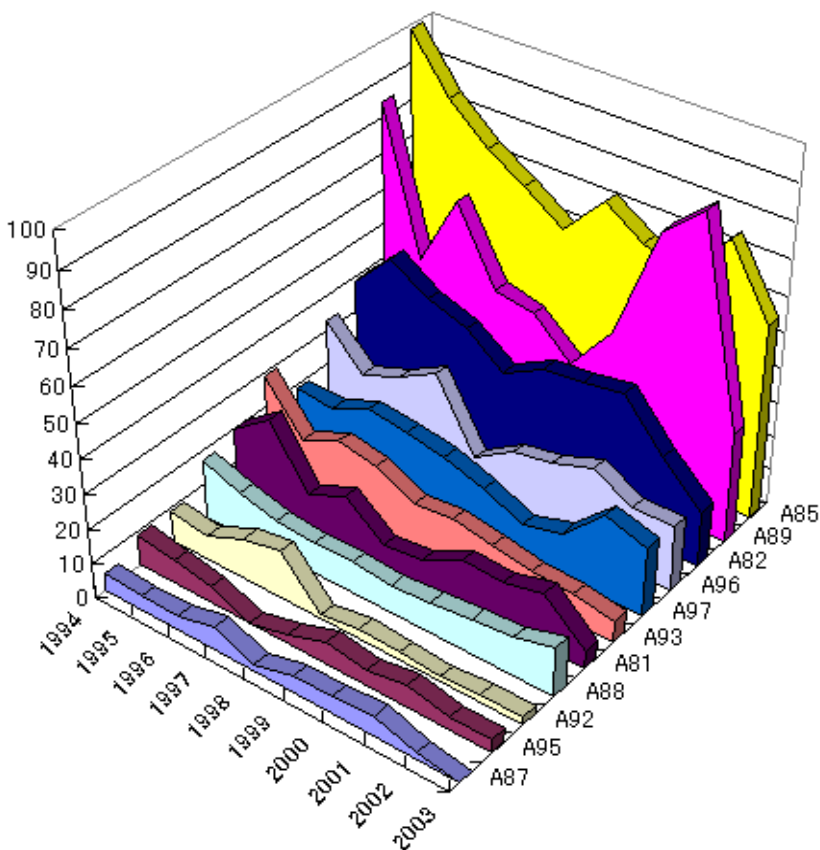
33:1.02;A96;1994

22:0.68;A96;1995

: 省略

↑
 デリミタ形式で再表示すると MS Excel
 でグラフを作成できる

REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : END



- A85: 電気的応用
- A89: 写真, 実験装置, 光学
- A82: コーティング, 含浸, 艶出し
- A96: 獣医薬, 医薬品, 歯科
- A97: その他の特定されない商品
- A93: 道路, 建築, 構築, 床
- A81: 接着剤および結合剤
- A88: 機械工学および道具
- A92: 包装および容器
- A95: 輸送
- A87: 繊維補助

STN の統計解析機能

解析例 2 : 信越化学工業のポリマー分野の技術動向調査

④ マニュアルコード (MC) でポリマー分野の技術動向の推移を見る。

=> D MC DOC TOP10

← マニュアルコードをレコード件数の多い順に上位 10 位まで表示する

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 SEL L3 1- PY. B DC MC PN : 9668 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY. B DC MC PN	
13	427	427	13.23	A12-E07C	← 半導体装置、集積回路;抵抗器
14	418	418	12.95	A06-A00B	← シリコンポリマー組成物
18	313	313	9.70	G06-F03C	← ポリマーを含む放射線感応組成物
21	282	282	8.74	A06-A00E1	← 接着剤およびバインダー;コーティング剤、 織物処理(シリコンポリマーの用途)
23	274	274	8.49	L04-C05	← マスキングおよびレジスト材料
25	258	258	7.99	A06-A00E2	← 化学工学、電気工学、および機械工学 (シリコンポリマーの用途)
26	257	257	7.96	A08-D01	← 架橋剤および促進剤;ポリマー関連添加剤-全般
27	243	243	7.53	G06-D06	← 電子エレメントの製造(写真)
29	239	239	7.40	U11-A06A	← 半導体デバイス製造用有機物レジスト
33	232	232	7.19	A08-R01	← ポリマー関連添加用フィラー・補強剤-全般
34	232	232	7.19	A12-L02B2	← 印刷配線など

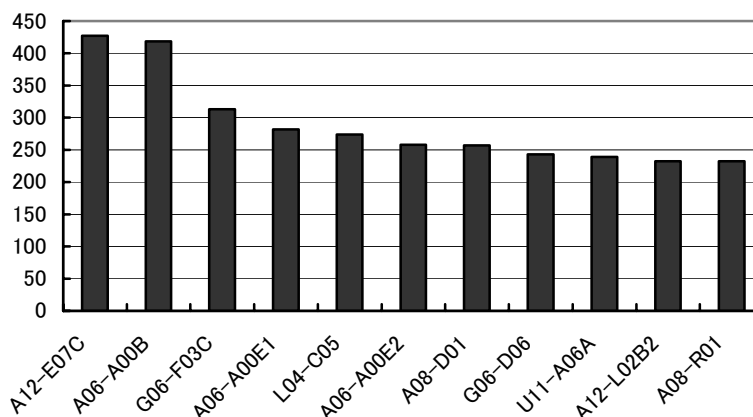
=> D MC DOC TOP10 DELIM

← デリミタ形式で再表示すると MS Excel でグラフを作成できる

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 SEL L3 1- PY. B DC MC PN : 9668 TERMS

13:427;427;13.23:A12-E07C
14:418;418;12.95:A06-A00B
: 省略



CPI マニュアルコードは会員用コードであるため、WPINDEX ファイルで検索に利用することはできないが、統計解析には利用することができる。

マニュアルコードの詳細は以下のサイトから調べることができる。
<http://www.derwent.co.jp/support/mc/index.html>

STN の統計解析機能

解析例 2 : 信越化学工業のポリマー分野の技術動向調査

=> D MC DOC WITH "A12" TOP10

← A12 で始まるマニュアルコードをレコード件数の多い順に上位 10 位まで表示する

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 SEL L3 1- PY. B DC MC PN : 9668 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY. B DC MC PN	
13	427	427	13.23	A12-E07C	← 半導体装置、集積回路;抵抗器
34	232	232	7.19	A12-L02B2	← 印刷配線など
40	202	202	6.26	A12-E04	← 埋込化合物、カプセル化組成物および同様の絶縁体
52	168	168	5.20	A12-B01C	← シリコンポリマーを含む無機ポリマー;ジエンまたはポリエン重合体(コーティング剤・塗料)
53	165	165	5.11	A12-E01	← ポリマーの電気工学的用途-全般
113	71	71	2.20	A12-L02E	← その他の放射線感受性の重合体組成物
117	67	67	2.08	A12-L03A	← 光ファイバ、ケーブル
118	67	67	2.08	A12-V01	← 医薬品、製剤
123	64	64	1.98	A12-R08	← シール材、グラウト、コーキング組成物
129	61	61	1.89	A12-E07A	← 印刷配線

=> D MC DOC WITH "A12" TOP10 DELIM

← デリミタ形式で再表示すると MS Excel でグラフを作成できる

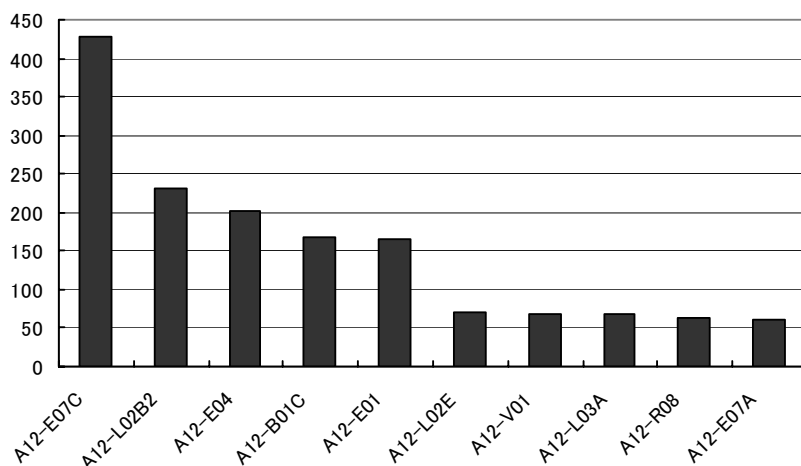
SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 ANALYZE L3 1- PY. B DC MC PN : 9668 TERMS

13:427:427:13.23:A12-E07C

34:232:232:7.19:A12-L02B2

: 省略



STN の統計解析機能

解析例 2 : 信越化学工業のポリマー分野の技術動向調査

=> TAB L4 GRID MC DOC D WITH "A12" TOP10 PY.B ALP A ← GRID 形式で A12 で始まるマニュアルコード上位 10 位までの特許発行年を二次元表示する

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 SEL L3 1- PY.B DC MC PN : 9668 TERMS

PY. B

MC	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
A12-E07C	59	37	38	29	36	33	39	64	61	31
A12-L02B2	32	13	22	13	18	11	15	45	49	14
A12-E04	30	17	23	18	17	21	18	22	15	21
A12-B01C	31	24	23	11	14	14	9	16	21	5
A12-E01	23	24	24	13	11	12	13	14	23	8
A12-L02E	11	10	7	7	10	2	4	7	11	2
A12-L03A	2	2	3	7	5	2	16	13	14	3
A12-V01	15	6	12	6	3	3	7	8	3	4
A12-R08	7	8	7	10	5	8	7	7	3	2
A12-E07A	10	11	10	5	5	3	5	4	2	6

REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : TAB DELIM MC DOC D WITH "A12" TOP10 PY.B ALP A

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 SEL L3 1- PY.B DC MC PN : 9668 TERMS

↑
デリミタ形式で再表示すると MS Excel
でグラフを作成できる

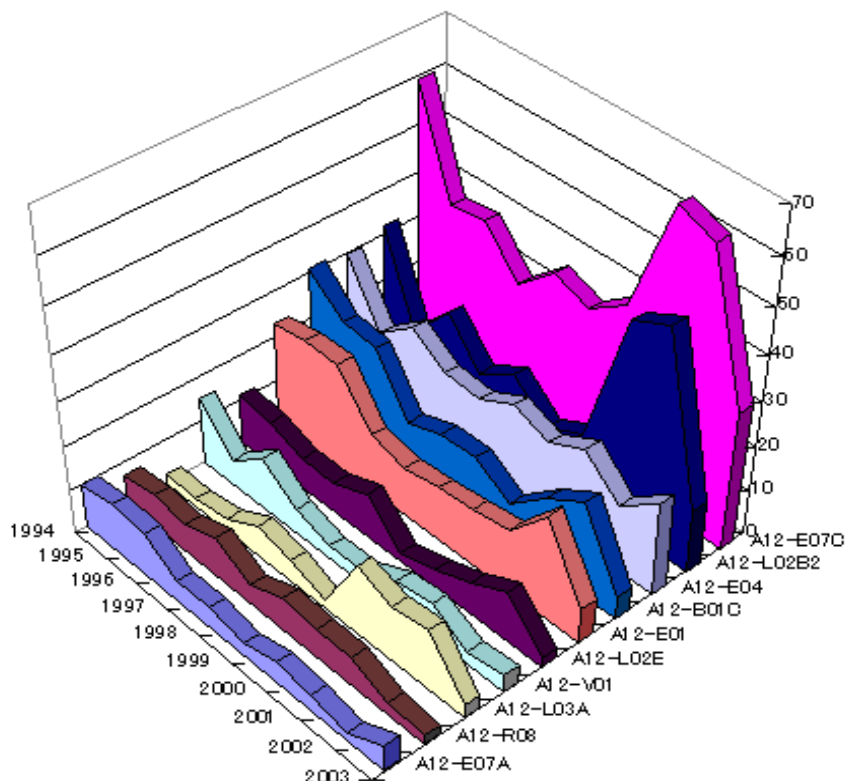
59:1.83:A12-E07C:1994

37:1.15:A12-E07C:1995

: 省略

6:0.19:A12-E07A:2003

REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : END



STN の統計解析機能

解析例 2 : 信越化学工業のポリマー分野の技術動向調査

⑤ ポリマー分野の特許の特許番号をリストアップする。

=> D PN ALP 1- ← 特許番号をアルファベット順で全件表示する

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 ANALYZE L3 1- PY. B DC MC PN : 9668 TERMS

TERM # # OCC # DOC % DOC PY. B DC MC PN

1	1	1	0.03	AT405941
2	1	1	0.03	AT9402070
3	1	1	0.03	AU2000067347

: 省略

=> D PN WITH "KR" 1- ← 韓国特許の特許番号をアルファベット順で全件表示する

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 ANALYZE L3 1- PY. B DC MC PN : 9668 TERMS

TERM # # OCC # DOC % DOC PY. B DC MC PN

6991	1	1	0.03	KR156018
6992	1	1	0.03	KR159808
6993	1	1	0.03	KR175976

: 省略

=> D PN WITH "KR" 1- ANS ← 韓国特許の特許番号を回答番号付きで全件表示する

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 ANALYZE L3 1- PY. B DC MC PN : 9668 TERMS

TERM # # OCC # DOC % DOC PY. B DC MC PN

6991	1	1	0.03	KR156018 (ANS: 2908)
6992	1	1	0.03	KR159808 (ANS: 2865)
6993	1	1	0.03	KR175976 (ANS: 1969)

: 省略

=> D PN WITH "KR" 1- ANS DELIM ← デリミタ形式で再表示すると MS Excel で表を作成できる

SHINETSU KAGAKU POLYMER PATENT (1994-2003)

L4 ANALYZE L3 1- PY. B DC MC PN : 9668 TERMS

6991:1:1:0.03:KR156018:2908

6992:1:1:0.03:KR159808:2865

: 省略

特許番号	回答番号
KR156018	2908
KR159808	2865
KR175976	1969
KR2000011354	921
KR2000011815	949
KR2000017263	946
KR2000023292	923
KR2000023368	917
KR2000023389	821
KR2000029366	882
KR2000035130	941
KR2000048200	956
KR99083454	1070
KR99088071	1067
KR99088140	874
KR99088166	1063
KR99088288	1024
KR99088289	973

STN の統計解析機能

解析例 2 : 信越化学工業のポリマー分野の技術動向調査

⑥ 信越化学工業ではどのようなポリマーを研究しているか.

```

=> FILE HCAPLUS                               ← HCAplus ファイルに入る
=> S ((SHINETSU OR SHIN(W)ETSU) (W) (CHEM? OR KAGAKU))/PA ← 信越化学工業の文献・特許を
    2549 SHINETSU/PA                             検索する
        : 省略
L10    9748 ((SHINETSU OR SHIN(W)ETSU) (W) (CHEM? OR KAGAKU))/PA

=> S L10 AND 1994-2003/PY.B                     ← 1994 年～2003 年に発行されたレコードに限定する
    8144870 1994-2003/PY.B
L11    4819 L10 AND 1994-2003/PY.B

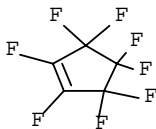
=> FILE ZREGISTRY                               ← ZREGISTRY ファイルに入る
        : 省略
L12    TRANSFER L11 1- RN : 15832 TERMS
        : 省略
L13    15829 L12

=> S L13 AND PMS/CI                             ← ポリマーに限定する
    998067 PMS/CI
L14    5011 L13 AND PMS/CI

=> D SCAN                                       ← SCAN 形式で構造をランダム表示する (無料)

L14 5011 ANSWERS  REGISTRY  COPYRIGHT 2004 ACS on STN
IN Cyclopentene, octafluoro-, polymer with 2-(ethenyloxy)-2-methylpropane
   (9CI)
MF (C6 H12 O . C5 F8)x
CI PMS

      CM 1
      t-BuO-CH=CH2

      CM 2
      
**PROPERTY DATA AVAILABLE IN THE 'PROP' FORMAT**

HOW MANY MORE ANSWERS DO YOU WISH TO SCAN? (1):2 ← 更に 2 件表示する
  
```



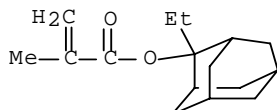
REGISTRY ファイルの回答セット (L14) は SCAN 表示形式で CA 索引名, 分子式, 構造図を無料で全件表示することができる。

STN の統計解析機能

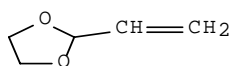
解析例 2 : 信越化学工業のポリマー分野の技術動向調査

L14 5011 ANSWERS REGISTRY COPYRIGHT 2004 ACS on STN
 IN 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-ethenyl-1,3-dioxolane and
 2-ethyltricyclo[3.3.1.1^{3,7}]dec-2-yl 2-methyl-2-propenoate (9CI)
 MF (C16 H24 O2 . C5 H8 O2 . C4 H6 O2)x
 CI **PMS**

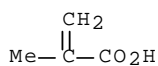
CM 1



CM 2

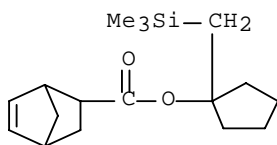


CM 3

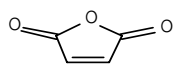


L14 5011 ANSWERS REGISTRY COPYRIGHT 2004 ACS on STN
 IN Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid, 1-
 [(trimethylsilyl)methyl]cyclopentyl ester, polymer with 2,5-furandione
 (9CI)
 MF (C17 H28 O2 Si . C4 H2 O3)x
 CI **PMS**

CM 1



CM 2



HOW MANY MORE ANSWERS DO YOU WISH TO SCAN? (1):END ← SCAN 表示を終了する

=> ANA L14 PCT

← ポリマークラスタームを統計解析する

: 省略

L15 ANALYZE L14 1- PCT : 59 TERMS

STN の統計解析機能

解析例 3 : エイズワクチンの技術動向調査

- ・ 解析例 3 : エイズワクチンの技術動向を調べる.
 - ・ 使用ファイル : HCAPLUS ファイル, ZCA ファイル
 - ・ 手順 ① エイズワクチンに関する特許を検索して ANALYZE コマンドを実行する.
 - ② 特許件数の推移を見る.
 - ③ どの企業が特許を発行しているか.
 - ④ どの国に特許が発行されているか.

① エイズワクチンに関する特許を検索して ANALYZE コマンドを実行する.

```
=> FILE HCAPLUS          ← HCAplus ファイルに入る
=> SET ABB ON            ← 略語自動検索の設定をする
SET COMMAND COMPLETED

=> SET PLU ON            ← 複数形自動検索の設定をする
SET COMMAND COMPLETED

=> S VACCINES/CT (L) (AIDS OR ACQUIRED (W) IMMUNE (W) DEFICIENCY (W) SYNDROME OR HIV)
      : 省略
L1      2399 VACCINES/CT (L) (AIDS OR ACQUIRED (W) IMMUNE (W) DEFICIENCY (W)
          SYNDROME OR HIV)

=> S ("AIDS (DISEASE)"/CT OR ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME/CT OR IMMUNODEFICIENCY/CT)
      (L) VACCINE
      : 省略
L2      523 ("AIDS (DISEASE)"/CT OR ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY ...

=> S L1 OR L2            ← エイズワクチンに関する文献・特許を検索する
L3      2548 L1 OR L2

=> S L3 AND A61K/IPC    ← A61K に属する国際特許分類が付与された特許に限定する
      : 省略          * A61K: 医薬用, 歯科用または化粧品用製剤
L4      556 L3 AND A61K/IPC

=> SAVE L4 AIDSVC/A
ANSWER SET L4 HAS BEEN SAVED AS 'AIDSVC/A'

=> ANA L4 PY. B CO PC    ← 以下の項目で統計解析を実行する
ANALYZE IS APPROXIMATELY 68% COMPLETE
L5      ANALYZE L4 1- PY. B PC CO :      482 TERMS
      * Basic 特許の発行年
      * 会社名
      * 特許発行国

=> EDIT L5 TITLE
ENTER TITLE OR (END) : AIDS VACCINE PATENT FROM CAPLUS

=> SAVE L5 AIDSVC1/Q
QUERY L5 HAS BEEN SAVED AS 'AIDSVC1/Q'
```

STN の統計解析機能

解析例 3 : エイズワクチンの技術動向調査

② 特許件数の推移を見る.

=> FILE ZCA ← 接続時間料の無料のファイルに入り解析結果を表示する

=> D PY.B ALP 1- ← 特許の発行年を数値順に全て表示する

AIDS VACCINE PATENT FROM CAPLUS

L5 ANALYZE L4 1- PY.B PC CO : 482 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY. B PC CO
463	1	1	0.18	1985
464	5	5	0.90	1986
465	15	15	2.70	1987
466	16	16	2.88	1988
467	11	11	1.98	1989
468	10	10	1.80	1990
469	25	25	4.50	1991
470	23	23	4.14	1992
471	20	20	3.60	1993
472	26	26	4.68	1994
473	31	31	5.58	1995
474	24	24	4.32	1996
475	20	20	3.60	1997
476	38	38	6.83	1998
477	38	38	6.83	1999
478	41	41	7.37	2000
479	55	55	9.89	2001
480	58	58	10.43	2002
481	87	87	15.65	2003
482	12	12	2.16	2004

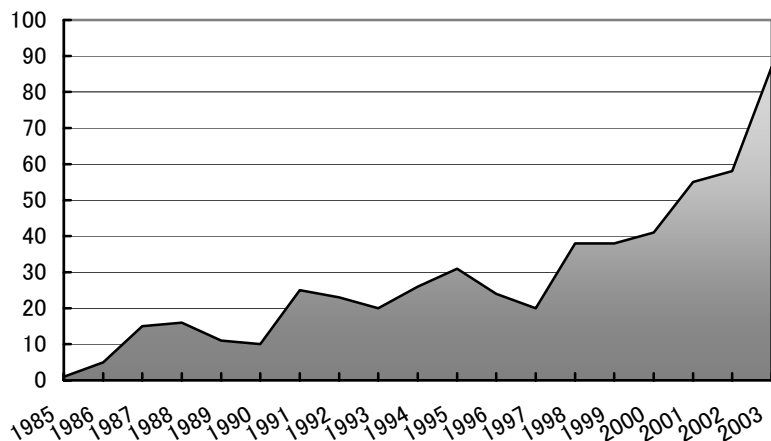
***** END OF L5 *****

=> D PY.B ALP 1- DELIM ← デリミタ形式で再表示すると MS Excel でグラフを作成できる

AIDS VACCINE PATENT FROM CAPLUS

L5 ANALYZE L4 1- PY.B PC CO : 482 TERMS

463;1;1;0.18;1985
 464;5;5;0.90;1986
 465;15;15;2.70;1987
 466;16;16;2.88;1988
 467;11;11;1.98;1989
 468;10;10;1.80;1990
 469;25;25;4.50;1991
 470;23;23;4.14;1992
 471;20;20;3.60;1993
 472;26;26;4.68;1994
 473;31;31;5.58;1995
 : 省略



STN の統計解析機能

解析例 3 : エイズワクチンの技術動向調査

③ どの企業が特許を出願しているか。

=> D CO TOP10 ← 会社名 (出願人名) をレコード件数の多い順に上位 10 位まで表示する

AIDS VACCINE PATENT FROM CAPLUS

L5 ANALYZE L4 1- PY. B PC CO : 482 TERMS

TERM # # OCC # DOC % DOC PY. B PC **CO**

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY. B PC	CO
24	24	24	4.32	MERCK AND CO INC	← 同じ出願人のデータが分かれていた
31	17	17	3.06	INSTITUT PASTEUR	
39	11	11	1.98	MERCK CO INC	
40	11	11	1.98	UNITED STATES DEPT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	
44	9	9	1.62	AVENTIS PASTEUR	
45	8	8	1.44	DUKE UNIVERSITY	
46	8	8	1.44	THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA	
47	7	7	1.26	GENENTECH INC	
48	6	6	1.08	MEDICAL RESEARCH COUNCIL	
49	6	6	1.08	TRANSGENE S A	

=> EDI L5 COM 24 39 ← 出願人データを統合する

PREFERRED TERM: MERCK AND CO INC/CO

EQUIVALENT TERM: MERCK CO INC/CO

APPLY CHANGES? (Y)/N:Y

TERMS COMBINED

=> D CO ALP 1- ← 出願人名をアルファベット順で全件表示する

AIDS VACCINE PATENT FROM CAPLUS

L5 ANALYZE PLU=ON L4 1- PY. B PC CO : 482 TERMS
(AFTER EDITS : 481 TERMS)

TERM # # OCC # DOC % DOC PY. B PC **CO**

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY. B PC	CO
1	1	1	0.18	AARON DIAMOND AIDS RESEARCH CENTER	← 同じ出願人のデータが分かれていた
2	1	1	0.18	AARON DIAMOND AIDS RESEARCH CENTRE	
3	1	1	0.18	ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM	
4	1	1	0.18	ADPROTECH LIMITED	
5	1	1	0.18	AGRESEARCH LIMITED	
6	1	1	0.18	AGUILAR RUBIDO JULIO CESAR	
7	2	2	0.36	AJINOMOTO CO INC	
8	4	4	0.72	AKZO NOBEL N V	

: 省略

@ INDICATES TERM AFFECTED BY MOST RECENT EDITS

=> EDIT L5 COMBINE ← 出願人データを統合する

: 省略

STN の統計解析機能

解析例 3 : エイズワクチンの技術動向調査

=> D CO DOC TOP8

← 出願人名をレコード件数の多い順に上位 8 位まで表示する

AIDS VACCINE PATENT FROM CAPLUS

L5 ANALYZE PLU=ON L4 1- PY.B PC CO : 482 TERMS
(AFTER EDITS : 478 TERMS)

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY.B PC CO
20*	35	35	6.29	MERCK AND CO INC
31	17	17	3.06	INSTITUT PASTEUR
39@	11	11	1.98	AVENTIS PASTEUR
40	11	11	1.98	UNITED STATES DEPT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
44	8	8	1.44	DUKE UNIVERSITY
45	8	8	1.44	THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
46	7	7	1.26	GENENTECH INC
47	6	6	1.08	MEDICAL RESEARCH COUNCIL
48	6	6	1.08	TRANSGENE S A

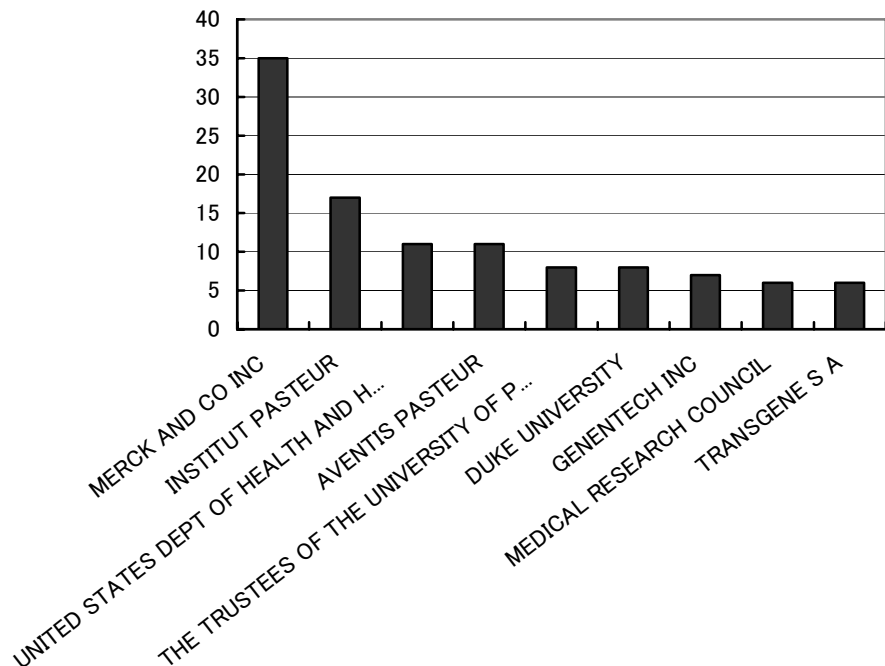
@ INDICATES TERM AFFECTED BY MOST RECENT EDITS

* INDICATES TERM AFFECTED BY PREVIOUS EDITS

=> D CO DOC TOP8 DELIM

: 省略

← デリミタ形式で再表示すると MS Excel でグラフを作成できる



CAplus/CA ファイルで出願人を解析する場合は、PA (出願人名) フィールドよりも CO (会社名) フィールドの利用が適している。一部の会社名が統制されているため解析後の編集作業がより簡単になる。

STN の統計解析機能

解析例 3 : エイズワクチンの技術動向調査

=> TAB L5 GRID CO DOC TOP8 PY. B ALP

← GRID 形式で会社名と特許発行年を二次元表示する

AIDS VACCINE PATENT FROM CAPLUS

L5 ANALYZE PLU=ON L4 1- PY. B PC CO : 482 TERMS
(AFTER EDITS : 478TERMS)

PY. B

CO	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
MERCK AND CO INC	0	0	0	0	1	0	2	7	2	2	6
INSTITUT PASTEUR	0	1	3	3	0	0	1	1	0	1	1
AVENTIS PASTEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNITED STATES DEPT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2
DUKE UNIVERSITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENENTECH INC	0	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0
MEDICAL RESEARCH COUNCIL	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0
TRANSGENE S A	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0

PY. B

CO	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
MERCK AND CO INC	2	2	1	1	0	3	3	3	0
INSTITUT PASTEUR	1	0	1	1	0	0	1	2	0
AVENTIS PASTEUR	0	0	0	0	0	3	3	5	0
UNITED STATES DEPT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	0	0	1	2	3	0	0	0	0
DUKE UNIVERSITY	0	1	0	1	0	0	3	1	0
THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA	0	0	1	2	1	2	1	1	0
GENENTECH INC	0	0	1	0	1	0	0	0	0
MEDICAL RESEARCH COUNCIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSGENE S A	0	0	0	1	0	0	0	0	0

STN の統計解析機能

解析例 3 : エイズワクチンの技術動向調査

REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : TAB DELIM CO DOC TOP8 PY.B ALP

AIDS VACCINE PATENT FROM CAPLUS

↑
 デリミタ形式で再表示すると MS Excel
 でグラフを作成できる

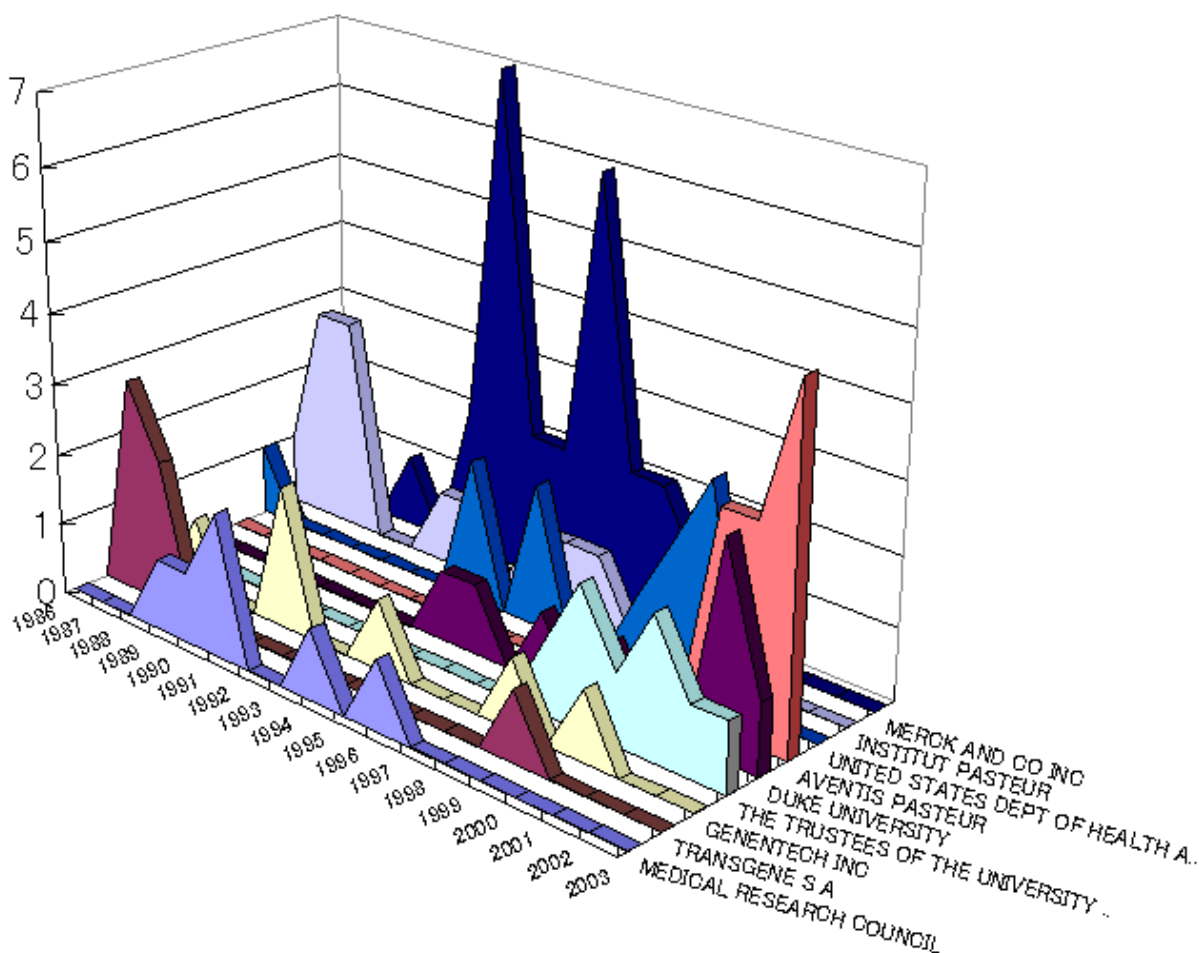
L5 ANALYZE PLU=ON L4 1- PY.B PC CO : 482 TERMS
 (AFTER EDITS : 478TERMS)

1:0.18:MERCK AND CO INC:1989
 2:0.36:MERCK AND CO INC:1991
 7:1.26:MERCK AND CO INC:1992

: 省略

1:0.18:TRANSGENE S A:1999

REFORMAT USING SAME DISPLAY FIELDS? (N), Y, OR ? : END



STN の統計解析機能

解析例 3 : エイズワクチンの技術動向調査

④ どの国に特許が出願されているか.

=> D PC DOC 1-

← 特許発行国をレコード件数の多い順に全件表示する

AIDS VACCINE PATENT FROM CAPLUS

L5 ANALYZE PLU=ON L4 1- PY. B PC CO : 482 TERMS
(AFTER EDITS : 478 TERMS)

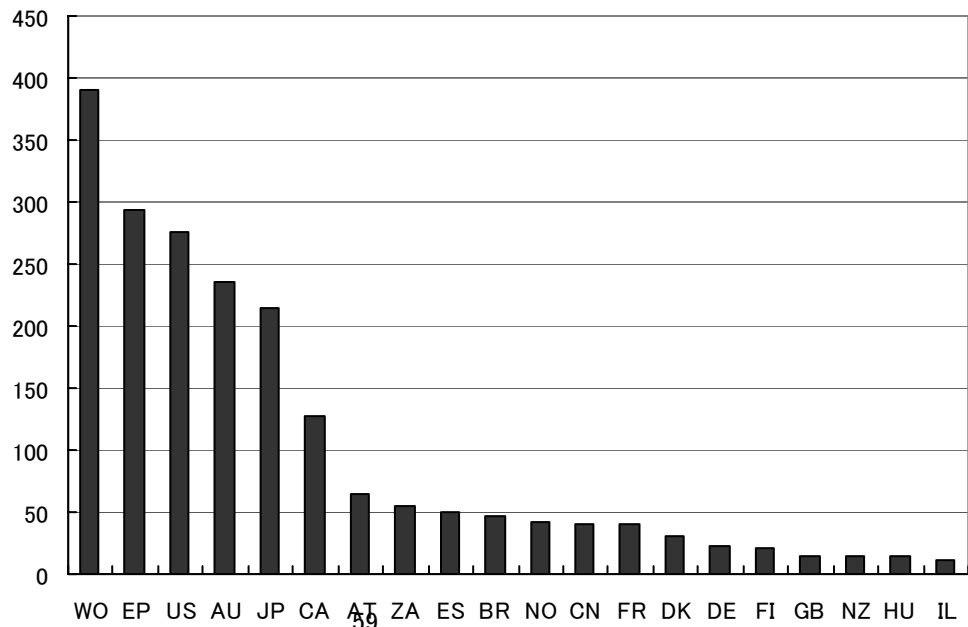
TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	PY. B PC CO	
1	408	391	70.32	WO	← PCT 出願
2	320	293	52.70	EP	← ヨーロッパ特許
3	530	276	49.64	US	← 米国
4	254	235	42.27	AU	← オーストラリア
5	246	215	38.67	JP	← 日本
6	131	127	22.84	CA	← カナダ
8	66	64	11.51	AT	← オーストリア
10	58	55	9.89	ZA	← 南アフリカ
12	61	50	8.99	ES	← スペイン
13	46	46	8.27	BR	← ブラジル
14	44	42	7.55	NO	← ノルウェー
15	41	41	7.37	CN	← 中国
17	49	40	7.19	FR	← フランス
: 省略					
319	1	1	0.19	LT	← リトアニア
341	1	1	0.19	MX	← メキシコ

=> D PC DOC 1- DELIM

← デリミタ形式で再表示すると MS Excel でグラフを作成できる

L6 ANALYZE L5 1-12, 14- : 496 TERMS

1:408;391;70.32;WO
2:320;293;52.70;EP
: 省略



STN の統計解析機能

参考例 : 光電子集積回路の検索語を調べる

- 参考例 : WPI で光電子集積回路に関する特許を検索するための検索語を調べる.
- 使用ファイル : WPINDEX ファイル (会員用ファイルは WPIDS/WPIX ファイル), ZCA ファイル
- 手順
 - ① 光電子集積回路に関する特許レコードを検索して ANALYZE コマンドを実行する.
 - ② 検索語として適切なダウエントクラス (DC) を探す.
 - ③ 検索語として適切なマニュアルコード (MC) を探す.
 - ④ 検索語として適切な国際特許分類 (IPC) を探す.
 - ⑤ コード類を利用した検索式を実行する.

① 光電子集積回路に関する特許レコードを検索して ANALYZE コマンドを実行する.

```
=> FILE WPINDEX                ← WPINDEX ファイルに入る
=> S OPTICAL INTEGRATED CIRCUIT/TI ← 光電子集積回路に関する特許を検索する (タイトル限定)
    308182 OPTICAL/TI
    122687 INTEGRATED/TI
    654244 CIRCUIT/TI
L1      309 OPTICAL INTEGRATED CIRCUIT/TI
        ((OPTICAL (W) INTEGRATED (W) CIRCUIT)/TI)

=> ANA DC MC ICM                ← 以下の項目で統計解析を実行する
L2      ANALYZE L1 1- DC MC ICM :    477 TERMS
        * ダウエントクラス
        * マニュアルコード
        * 国際特許分類の主分類
```

② 検索語として適切なダウエントクラス (DC) を探す.

```
=> D L2 DC                ← ダウエントクラスをレコード件数の多い順に上位 10 位まで表示する
L2      ANALYZE L1 1- DC MC ICM :    477 TERMS
```

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	DC	MC	ICM
1	203	203	65.70	P81		
2	196	196	63.43	V07		
3	141	141	45.63	U13		
4	125	125	40.45	U12		
6	81	81	26.21	V08		
8	66	66	21.36	L03		
27	15	15	4.85	W04		

← 上位にあるダウエントクラスの内容をチェックする
 * ダウエントクラスの詳細は以下のサイトからダウンロードできる
<http://www.derwent.co.jp/support/mc/index.html>

```
=> E P81/DC 5                ← ダウエントクラスの大まかな内容は EXPAND コマンドでチェックすることもできる
E1      0                    P78 Decorative/DC
E2      0                    P8 Optics, Photography, General/DC
E3      301197 --> P81/DC
E4      0                    P81 Optics/DC ← 光学
E5      101197               P82/DC
```

STN の統計解析機能

参考例 : 光電子集積回路の検索語を調べる

```
=> E V07/DC 5
E1      213299    V06/DC
E2         0      V06 Electromechanical Transducers, Small Machines/DC
E3     148393 --> V07/DC
E4         0      V07 Fibre Optics and Light Control/DC ← ファイバー光学機器
E5      67135    V08/DC
```

```
=> E U13/DC 5
E1     230287    U12/DC
E2         0      U12 Discrete Devices/DC
E3     139378 --> U13/DC
E4         0      U13 Integrated Circuits/DC ← 集積回路
E5     263720    U14/DC
```

③ 検索語として適切なマニュアルコード (MC) を探す.

```
=> D MC ← マニュアルコードをレコード件数の多い順に上位 10 位まで表示する
L2      ANALYZE L1 1- DC MC ICM :      477 TERMS
```

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	DC MC ICM
5	119	119	38.51	V07-F01A5 ← 上位にあるマニュアルコードの内容をチェックする
7	71	71	22.98	U13-D04A * マニュアルコードの詳細は以下のサイトからダウンロード
9	60	60	19.42	V08-A04A できる.
11	41	41	13.27	L03-G02 http://www.derwent.co.jp/support/mc/index.html
14	31	31	10.03	L04-F04
15	27	27	8.74	U13-D04
16	27	27	8.74	V07-F01A5A
17	27	27	8.74	V07-G10C
18	21	21	6.80	U12-A01C
20	20	20	6.47	U12-A01B
21	20	20	6.47	U12-A01B1

```
=> E V07-F01A5+ALL/MC ← マニュアルコードの大まかな内容はオンラインソーラスでチェック
E1     140464    BT4  V07/MC  することもできる
E2         447    BT3  V07-F/MC
DEF OPTICAL ELEMENTS
HNT (1983- )
E3     1217     BT2  V07-F01/MC
DEF LIGHT GUIDES
HNT (1983- )
E4     6434     BT1  V07-F01A/MC
DEF GUIDING STRUCTURES
HNT (1983- )
E5     7709     --> V07-F01A5/MC
DEF INTEGRATED OPTICAL WAVEGUIDES ← 集積光導波路
HNT (1983- )
E6     1699     RT   V07-F01A5A/MC
DEF CHARACTERISED BY INTEGRATED OPTICAL WAVEGUIDE
MANUFACTURE
```

```
: 省略
***** END *****
```

STN の統計解析機能

参考例 : 光電子集積回路の検索語を調べる

```
=> E U13-D04A+ALL/MC
E1      128325  BT3  U13/MC
E2      3621   BT2  U13-D/MC
          DEF  INTEGRATED CIRCUIT STRUCTURES
E3      2172   BT1  U13-D04/MC
          DEF  INTEGRATED CIRCUIT STRUCTURE IN COMBINATION WITH OTHER
          ELEMENTS
          HNTE (1987- )
E4      2912   --> U13-D04A/MC
          DEF  OPTO-ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS ← 光電子集積回路
          HNTE (1992- )
***** END *****
```

```
=> E V08-A04A+ALL/MC
E1      60645  BT3  V08/MC
E2      247    BT2  V08-A/MC
          DEF  LASERS
E3      167    BT1  V08-A04/MC
          DEF  LASER TYPES
E4      30224  --> V08-A04A/MC
          DEF  SEMICONDUCTOR LASER ← 半導体レーザー
***** END *****
```

④ 検索語として適切な国際特許分類 (IPC) を探す.

=> FILE ZCA ← 接続時間料の無料のファイルに入り解析結果を表示する

=> D ICM ← 国際特許分類をレコード件数の多い順に上位 10 位まで表示する
L2 ANALYZE L1 1- DC MC ICM : 477 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	DC MC ICM	
12	40	40	12.94	G02B006-12	← 上位の国際特許分類はサブクラスの共通するものが多かった
13	37	37	11.97	G02B006-122	
22	19	19	6.15	G02B006-13	
25	16	16	5.18	H01L027-15	
31	12	12	3.88	G02B006-42	
32	11	11	3.56	G02B006-30	
48	7	7	2.27	G02B006-26	
49	7	7	2.27	H01S003-18	
53	6	6	1.94	G01C019-72	
60	5	5	1.62	H01L021-00	
61	5	5	1.62	H01L027-14	

=> ANA L2 LEN4 ← 解析結果の全タームから上 4 文字を解析し直す
L3 ANALYZE L2 1- LEN 4 : 121 TERMS

STN の統計解析機能

参考例 : 光電子集積回路の検索語を調べる

=> D ICM ← 国際特許分類のサブクラスをレコード件数の多い順に上位 10 位まで表示する
L3 ANALYZE L2 1- LEN 4 : 121 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	DC MC ICM
5	155	129	41.75	G02B
15	53	44	14.24	H01L
22	20	16	5.18	H01S
28	11	10	3.24	G02F
37	6	6	1.94	G01C
41	6	5	1.62	G11B
52	3	3	0.97	H05B
58	3	2	0.65	H04B
61	2	2	0.65	B28D
62	2	2	0.65	G01R
64	2	2	0.65	G06K
65	2	2	0.65	H01J
72	2	1	0.32	H05K

国際特許分類の内容はオンラインシソーラスでチェックすることもできる

=> E G02B+INDEX/IC
E1 32374 -->

G02B/IC ← 光学要素, 光学系, または光学装置
OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS (G02F takes precedence; optical elements specially adapted for use in lighting devices or systems thereof F21V001-00 to F21V013-00; measuring-instruments, see the relevant : 省略
heating arrangements specially adapted for transparent or reflecting areas H05B003-84) (1,7)

***** END *****

=> E H01L+INDEX/IC
E1 219509 -->

H01L/IC ← 半導体装置, 他に属さない電氣的固体装置
SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR (conveying systems for semiconductor wafers B65G049-07; use of semiconductor : 省略
see the subclass for the application) (2)

***** END *****

=> D L2 ICM TOP5 ← 国際特許分類をレコード件数の多い順に上位 5 位まで表示する
L2 ANALYZE L1 1- DC MC ICM : 477 TERMS

TERM #	# OCC	# DOC	% DOC	DC MC ICM
12	40	40	12.94	G02B006-12
13	37	37	11.97	G02B006-122
22	19	19	6.15	G02B006-13
25	16	16	5.18	H01L027-15
31	12	12	3.88	G02B006-42

STN の統計解析機能

参考例 : 光電子集積回路の検索語を調べる

```
=> E G02B006-12+INDEX/IC
E1      1874  --> G02B006-12/IC
          . . . of the integrated circuit kind (production or
          processing of single crystals C30B; electric integrated
          circuits H01L027-00) (4)
***** END *****
```

```
=> E H01L027-15+INDEX/IC
E1      822  --> H01L027-15/IC
          . including semiconductor components with at least one
          potential-jump barrier or surface barrier adapted for
          light emission (2)
***** END *****
```

```
=> LOG Y          ← セッションを終了して質問式を検討する
```

⑤ コード類を利用した質問式を実行する.

```
=> FILE WPINDEX          ← WPINDEX ファイルに入る
SET COMMAND COMPLETED

=> SET PLU ON           ← 複数形自動検索の設定をする
SET COMMAND COMPLETED

=> SET ABB ON          ← 略語自動検索の設定をする
SET COMMAND COMPLETED

=> S OPTICAL INTEGRATED CIRCUIT
      : 省略
L4      641 OPTICAL INTEGRATED CIRCUIT
          (OPTICAL (W) INTEGRATED (W) CIRCUIT)

=> S (OPTICAL OR OPTOELECTRONIC) (3A) (CIRCUIT OR IC)
      : 省略
L5      15031 (OPTICAL OR OPTOELECTRONIC) (3A) (CIRCUIT OR IC)

=> S U13-D04A/MC        ← 光電子集積回路のマニュアルコードで検索する
U13-D04A OPTO-ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS
L6      2912 U13-D04A/MC

=> S (OPTICAL OR OPTOELECTRONIC OR V07-F01A5/MC OR G02B006/IC) AND (U13/DC OR H01L027/IC)
      : 省略
L7      9861 (OPTICAL OR OPTOELECTRONIC OR V07-F01A5/MC OR G02B006/IC) AND
          (U13/DC OR H01L027/IC)

=> S L4-7
L8      24325 (L4 OR L5 OR L6 OR L7)
```